

③水文地質（第2次）

表 5.3 「水文地質」(第2次)の指導行程

指導項目	テキスト/ アウトプット	指導 形態	対象者	日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
					M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	
現地業務																																										
1 移動(東京-ラパス-トニダ)	-	-	-	3																																						
2 各種データまとめ・解析・サイト視察	調査結果	OJT	ベニ県 調査班	4																																						
3 掘削結果と各種調査の整合性考察	調査結果	講義	ベニ県 調査班	3																																						
4 指導報告書作成・翻訳・評価	報告書・評価表	講義	ベニ県 調査班	3																																						
5 移動(トニダ-コビハ)	-	-	-	1																																						
6 各種データまとめ・解析	調査結果	OJT	バンド県 調査班	4																																						
7 掘削結果と各種調査の整合性考察	調査結果	講義	バンド県 調査班	3																																						
8 指導報告書作成・翻訳・評価	報告書・評価表	-	-	3																																						
9 移動(コビハ-ラパス)	-	-	-	1																																						
10 資料整理	-	-	-	2																																						
11 移動(ラパス-東京)	-	-	-	3																																						
合計				30																																						

⑥運営維持管理・衛生教育（第2次）

表 5.6 「運営維持管理・衛生教育」(第2次)の指導行程

指導項目	テキスト/ アウトプット	指導 形態	対象者	日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
					M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M
現地業務																																								
1 移動(東京・ラハス-リニダ)	-	-	-	3																																				
2 運営維持管理・モニタリング手法	運営維持管理・衛生教育テキスト	講義	ベニ県・バント県 社会開発担当	5																																				
3 衛生教育手法	運営維持管理・衛生教育テキスト	講義	ベニ県・バント県 社会開発担当	2																																				
3 住民に対する啓発・料金設定ワークショップ	運営維持管理・衛生教育テキスト	OJT	ベニ県・バント県 社会開発担当	2																																				
4 住民に対する衛生教育ワークショップ	運営維持管理・衛生教育テキスト	OJT	ベニ県・バント県 社会開発担当	1																																				
4 委員会に対する運営維持管理手法指導	運営維持管理・衛生教育テキスト	OJT	ベニ県・バント県 社会開発担当	3																																				
5 移動(リニダ-コビハ)	-	-	-	1																																				
6 住民に対する啓発・料金設定ワークショップ	運営維持管理・衛生教育テキスト	OJT	ベニ県・バント県 社会開発担当	2																																				
7 住民に対する衛生教育ワークショップ	運営維持管理・衛生教育テキスト	OJT	ベニ県・バント県 社会開発担当	1																																				
8 委員会に対する運営維持管理手法指導	運営維持管理・衛生教育テキスト	OJT	ベニ県・バント県 社会開発担当	3																																				
9 移動(コビハ-ラハス)	-	-	-	1																																				
10 資料整理	-	-	-	3																																				
11 移動(ラハス-東京)	-	-	-	3																																				
合計				30																																				

⑦運営維持管理・衛生教育（第3次）

表 5.7 「運営維持管理・衛生教育」(第3次)の指導行程

指導項目	テキスト/ アウトプット	指導 形態	対象者	日数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
					M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M
現地業務																																								
1	移動(東京-ラハス-トニダ)	-	-	3																																				
2	サイト間移動	-	-	4																																				
2	運営維持管理・衛生教育テキスト	OJT	ベニ県 社会開発担当	3																																				
3	運営維持管理・衛生教育テキスト	OJT	ベニ県 社会開発担当	-																																				
3	住民に対するワークショップ	OJT	ベニ県 社会開発担当	3																																				
5	移動(トニダ-コビハ)	-	-	1																																				
2	施設運転状況の確認	OJT	バンド県 社会開発担当	3																																				
3	運営状況の確認	OJT	バンド県 社会開発担当	-																																				
3	住民に対するワークショップ	OJT	バンド県 社会開発担当	3																																				
8	指導報告書作成・翻訳・評価	報告書・評価表	-	3																																				
9	移動(コビハ-ラハス)	-	-	1																																				
10	資料整理	-	-	3																																				
11	移動(ラハス-東京)	-	-	3																																				
合計				30																																				

6. ソフトコンポーネントの実施リソースの調達方法

ソフトコンポーネントにかかるリソースは、高度な応用力および指導能力が求められることから、コンサルタントが派遣する日本人技術者とする。これらの専門技術者はOJT形式で実施するほか、理論面からも指導を実施する。

また「井戸工事運営管理」の担当分野に関しては、ベニ県およびバンド県2県において平行した業務が発生することから、日本人技術者に加え現地傭人「井戸工事運営管理補助」を配置し補助的な指導・監理を行う体制とする。なお、「井戸工事運営管理補助」は地下水開発全般に関する専門的な知識・技術や類似業務の経験を持った要員が必要となる。

7. ソフトコンポーネントの実施工程

表 7.1 にソフトコンポーネントの実施工程を、OJT 対象村落の施工行程、および調達業者による運用指導行程とあわせて示す。

「井戸工事運営管理」担当は井戸掘削の準備段階から、OJT 対象 5 村落への掘削が終了するまでの期間において指導を行う。「水文地質」担当は、機材引渡後から現地入りする「物理探査」担当から業務を引き継ぐ形で 1 回目の派遣が行われ、2 回目は 4 井目の掘削が完了後速やかに再度現地入りする。「運営管理・衛生教育」担当はコンサルタント契約直後に 1 回目の派遣、掘削が開始される直前に 2 回目、4 井目の掘削が完了するタイミングで 3 回目の派遣を計画する。

8. ソフトコンポーネントの成果品

ソフトコンポーネントの成果品に関しては、表 5.1 に記載したとおりとする。担当分野ごとの指導テキストを日本人技術者が作成するほか、OJT を通した両県との協働作業の中で次の報告書を作成する。その他、日本国側報告資料として指導の達成度を確認したチェックシートや、ソフトコンポーネント実施状況報告書および、完了報告書の作成を行う。

- ✓ 施工関連：
孔内検層結果、揚水試験結果、工程管理や品質管理等の施工報告書（月報）、施設完成図書を作成する。
- ✓ CAP y S(水衛生委員会)関連：
三者間協定書、委員会定款、運用管理、運転維持管理マニュアル、各種記録簿、モニタリング報告書などが成果品となる。
- ✓ 各種調査：
電気探査結果、現場踏査報告書、それぞれの調査結果の分析・解析報告書、およびデータベースが作成される。

表 7.1 掘削工程および技術指導要員計画

号級	2011年						2012年						2013年									
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
機材調達	E/N ▼コンクリート契約																					
開掘・機械調整・初期指導	▼機材引渡																					
7 サン・アソ・テ・アガ・ト・カレ	■																					
6 サン・ホマキン	■																					
20 エル・カルメン・テ・マニキ	■																					
4 フリメ・ロ・テ・マヨ	■																					
9 ラ・アルヘイナ	■																					
機材整備	■																					
開掘・機械調整・初期指導	■																					
10 アハロア(バルテ・テル・アケ)	■																					
4 カチオン	■																					
9 ロレ	■																					
6 アルカ・テ・イヌエル	■																					
1 フェルト・ロ	■																					
機材整備	■																					
1 井戸工事運営管理	■																					
2 水文地質	■																					
3 物理探査	■																					
3 運営管理・衛生教育	■																					
4 井戸工事運営管理(ローカル)	■																					
(1) 通訳1(ローカル)	■																					
(2) 通訳2(ローカル)	■																					
(4) 運転手1(ローカル)	■																					
(5) 運転手2(ローカル)	■																					
(6) 運転手3(ローカル)	■																					
日本人合計	3.0 15.3 18.3																					
1 井戸掘削技術 1	■																					
3 井戸掘削技術 2	■																					
3 ホン挿入・電気・配電	■																					
4 ホン挿入・電気・配電	■																					
4 水質分析操作	■																					
4 機材整備	■																					
(1) 井戸掘削技術助手1(ローカル)	■																					
(2) 井戸掘削技術助手2(ローカル)	■																					
(3) 通訳ベニ巣(ローカル)	■																					
(4) 通訳バンド県(ローカル)	■																					
日本人合計	2.3 21.0 23.3																					
国内	0.75 7.33 8.08																					
現地	0.75 3.00 3.75																					
合計	1.50 10.33 11.83																					
国内	0.75 1.50 2.25																					
現地	0.75 3.50 4.25																					
合計	1.50 5.00 6.50																					
国内	0.75 7.00 7.75																					
現地	0.75 7.00 7.75																					
合計	1.50 14.00 15.50																					
国内	0.75 1.30 2.05																					
現地	0.75 1.30 2.05																					
合計	1.50 2.60 4.10																					
国内	0.75 7.00 7.75																					
現地	0.75 7.00 7.75																					
合計	1.50 14.00 15.50																					
国内	0.75 15.3 16.05																					
現地	0.75 15.3 16.05																					
合計	1.50 30.6 32.1																					

・水中ポンプ・配電盤の設置

・市役所の予算確保支援
・水委員会の形成支援

テキスト・マニュアル作成

9. ソフトコンポーネントの概算事業費

ソフトコンポーネントにかかる概算事業費は次のとおりである。

ソフトコンポーネント概算事業費 : 55,346 千円

【内訳】

①直接人件費	: 14,260 千円
②直接経費	: 22,833 千円
③間接費	: 18,253 千円

10. 相手国実施機関の責務

本プロジェクトにおける両国の負担区分は表 10.1 のとおりとなる。日本側では機材調達を実施するほか、「ボ」国側が実施する両県 5 村落分の井戸掘削に対して OJT 形式による技術指導を実施する。このため、「ボ」国側は機材調達にかかる諸手続きを実施するほか、この OJT 形式による技術指導が適切に実施できるよう、予算やカウンターパートの確保など負担区分表に記された項目を遵守する必要がある。また適切な指導を実施するためには、指導期間中のカウンターパートの宿泊・日当、安全管理装備等に関して、「ボ」国側の迅速な対応が求められる。

また調達された機材以外の給水施設建設にかかる必要資機材は、「ボ」国側の負担となるほか、指導期間に発生した事故・災害等に関しては、全て「ボ」国側の責任となる。

技術指導で実施される 5 本の井戸掘削で習得できるレベルは、過去の経験から、一連の井戸掘削作業の手順・操作を理解し安全に作業を行える段階までとなる。このため、日本側指導期間終了後において効率的で最適な品質の井戸掘削が可能となるまでには、経験の豊富な他県からの支援と、ベニ県、パンド県の自助努力が必須である。

表 10.1 資機材調達・施工負担区分・技術指導項目および(案)

1. 機材調達関連

	項目	日本側(無償)	「ボ」国側
1	井戸掘削機材	○	
2	井戸掘削用ツールズ類	○	
3	上記スペアパーツ(2年分程度)	○	
4	支援車両	○	
5	揚水試験用機材	○	
6	調査機器	○	
7	資機材の保管場所までの輸送	○	
8	輸入手続、免税・還付手続き等		○
9	機材、スペアパーツの保管場所の確保と整備		○
10	ワークショップの確保と整備		○
11	機材管理者、整備工の確保		○
12	機材管理者、整備工への技術支援	○(技術支援)	
13	日本側調達機材以外に発生する全ての機材		○
14	主要機材にかかる損害保険への加入		○

2. 井戸工専用建設資材(ベニ県20村落、バンド県15村落)

	項目	日本側	「ボ」国側
1	ケーシング	○	
2	スクリーン	○	
3	揚水用ポンプ(含揚水管、配電盤)、発電機	○	
4	掘削ビット	○	
5	ベントナイト、その他の調泥材	○(指導分)	○
6	調達資材の県の保管場所までの輸送	○	
7	調達資材にかかる税金の還付		○
8	充填砂利	○(指導分)	○
9	燃料、オイル		○
10	グラウチング用セメント		○
11	塩素滅菌器		○
12	浄水処理器(鉄・マンガン)		○
13	日本側調達資材以外に発生する全ての資材		○

3. 給水施設建設および運営・維持管理(技術移転対象村落)

	項目	日本側	「ボ」国側
1	井戸建設(井戸掘削～揚水試験実施まで)	○(技術支援)	○
2	制御建屋の建設/塩素滅菌器の設置		○
3	浄水処理器(鉄・マンガン)の設置	○(技術支援)	○
4	揚水ポンプ、配電盤の設置	○(技術支援)	○
5	井戸元～配水池までの導水管の設置		○
6	井戸～既存施設の接続		○
7	配水池～共同水栓/各戸配管施設の設置		○
8	太陽光/発電機の設置	○(技術支援)	○
9	商用電源の確保、トランスの設置		○
10	運転・維持管理*	○(技術支援)	○
11	モニタリングおよび改善指導*	○(技術支援)	○
12	住民への衛生教育、啓蒙活動*	○(技術支援)	○
13	生産性向上活動の実施*		○

*:生命の水プロジェクトによる指導

4. 調査・手続き・その他の管理(技術移転対象村落)

	項目	日本側	「ボ」国側
1	日本人技術者の派遣	○	
2	必要予算の確保		○
3	適切な要員の確保		○
4	要員の残業、宿泊・日当等の負担		○
5	必要な消耗品(燃料・資材)の確保		○
6	安全対策(ヘルメット、作業靴等)の実施		○
7	井戸建設用地・アクセスの確保		○
8	工事手続き、環境ライセンスの取得		○
9	施工計画・管理、品質管理、安全管理	○(技術支援)	○
10	現地調査(地下水調査)の実施	○(技術支援)	○
11	村落水委員会の形成	○(技術支援)	○
12	県一市一村落との調整・合意の形成	○(技術支援)	○
13	建設された全ての施設の瑕疵責任		○
14	期間中に発生した従事者、第三者の傷害に対する責任		○

SEV 1 14 DE SEPTIEMBRE

Schlumberger Array

Northing: 8780166.0 Easting: 246599.0 Elevation: 0.0

【ベニ県】

No.	Spacing (meters)	AB/2 M/N	Data		Layered Model:		Smooth Model:	
			Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	
1	1.50	0.500	964.4	994.7	-3.14			
2	3.00	0.500	1856.5	1822.6	1.82			
3	5.00	0.500	2949.0	2634.6	10.66			
4	7.00	0.500	3266.2	3123.4	4.36			
5	10.00	0.500	3175.0	3386.1	-6.70			
6	15.00	0.500	3250.1	3086.3	5.03			
7	20.00	0.500	2264.7	2433.4	-7.44			
8	25.00	0.500	1966.6	1776.4	10.46			
9	30.00	0.500	1102.1	1248.5	-13.29			
10	40.00	0.500	522.1	604.7	-15.80			
11	25.00	5.00	1903.3	1769.8	7.01			
12	30.00	5.00	1071.1	1243.4	-16.09			
13	40.00	5.00	512.3	601.4	-17.37			
14	50.00	5.00	259.5	333.8	-28.61			
15	60.00	5.00	186.5	245.8	-31.78			
16	75.00	5.00	218.1	236.4	-8.39			
17	100.00	5.00	316.5	295.1	6.75			
18	125.00	5.00	481.2	364.1	24.34			
19	150.00	5.00	515.4	432.4	16.09			
20	175.00	5.00	560.4	499.5	10.66			
21	225.00	25.00	458.0	351.0	23.36			
22	150.00	25.00	496.7	417.7	15.90			
23	175.00	25.00	543.6	483.0	11.13			
24	200.00	25.00	508.1	547.1	-7.66			
25	250.00	25.00	758.5	671.6	11.45			
26	300.00	25.00	759.8	791.5	-4.17			

NO DATA ARE MASKED

Layered Model

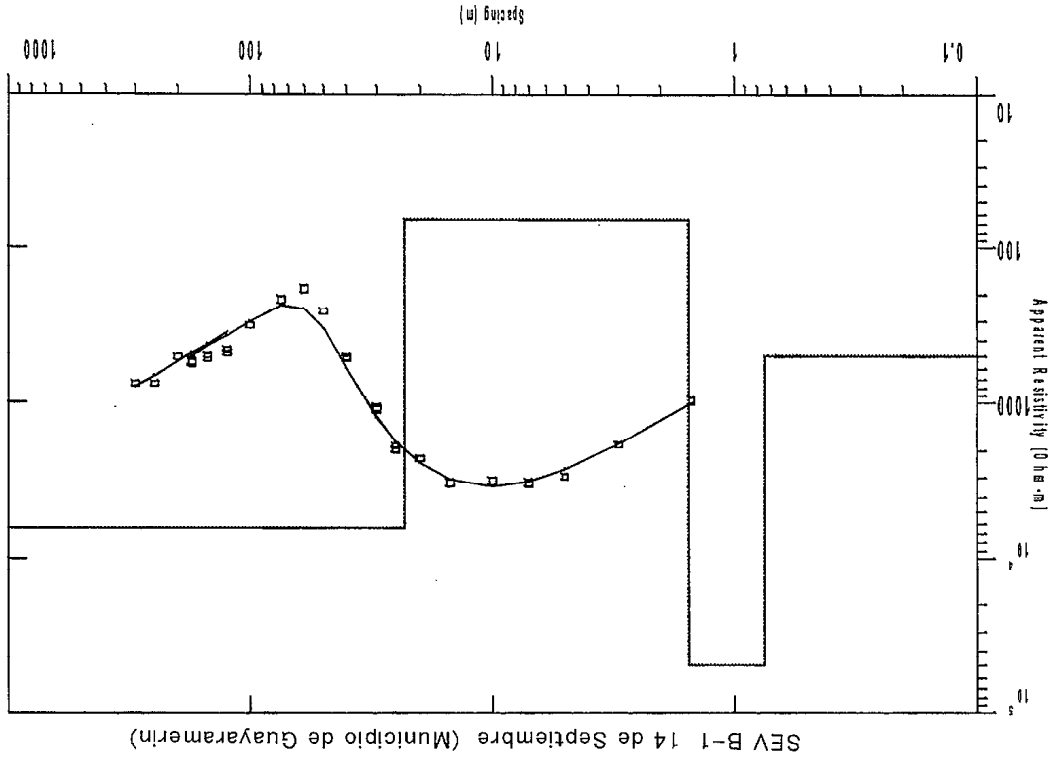
L #	RESISTIVITY	THICKNESS (meters)	DEPTH (meters)	ELEVATION	LONG. COND. TRANS. RES. (Siemens) (Ohm-m ²)
1	498.1	0.753	0.753	0.0	0.00151 375.5
2	48319.7	0.790	1.54	-0.753	1.603E-05 38991.3
3	6475	21.63	23.18	-1.54	0.334 1401.0
4	6410.6			-23.18	

SEV 4 14 DE SEPTIEMBRE

Page 2

ALL PARAMETERS ARE FREE

6. 参考資料 (電気探査結果)



SEV 2 BUENA VISTA

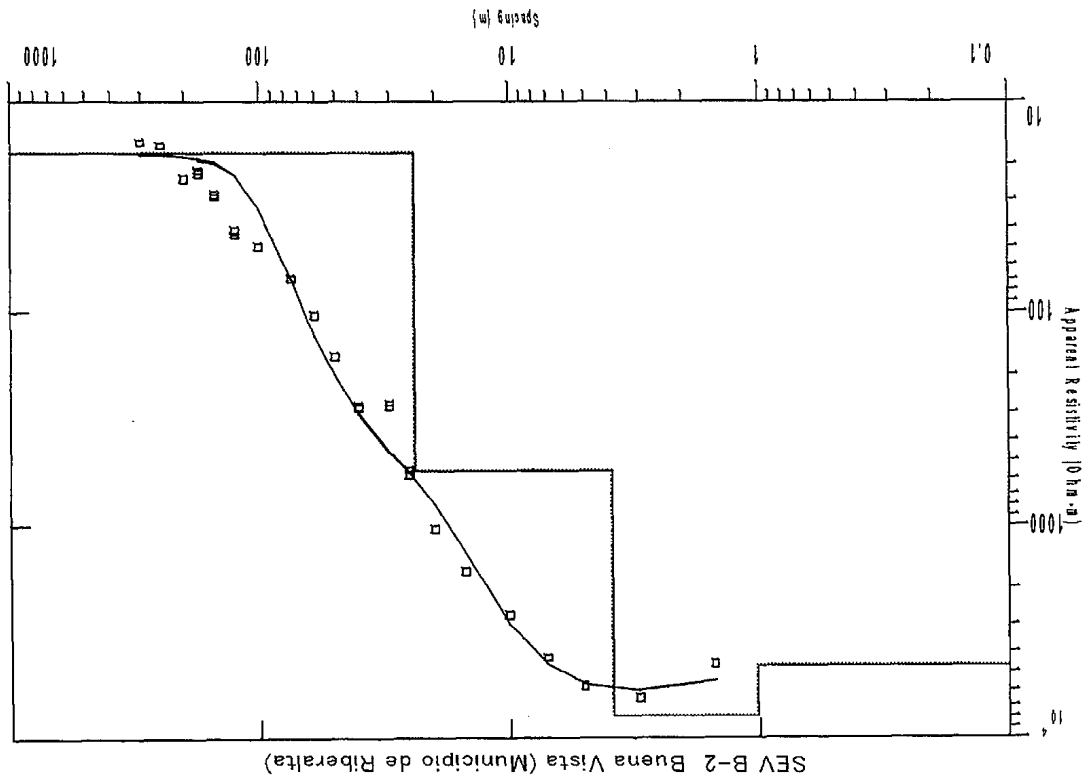
Schlumberger Array

Northing: 8798850.0 Easting: 192537.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters)	AB/2	M/N	Data		Layered Model:		Smooth Model:	
				Resistivity	Synthetic Resistivity	Synthetic Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	DIFFERENCE
1	1.50		0.500	4574.4	5427.8	-18.65			
2	3.00		0.500	6536.6	6035.4	7.36			
3	5.00		0.500	5803.6	5681.2	2.10			
4	7.00		0.500	4232.2	4606.8	-7.32			
5	10.00		0.500	2696.9	2973.7	-10.67			
6	15.00		0.500	1675.7	1392.8	16.88			
7	20.00		0.500	1047.5	799.9	23.63			
8	25.00		0.500	579.1	573.0	1.05			
9	30.00		0.500	282.3	467.4	-62.00			
10	40.00		0.500	286.4	309.8	-8.17			
11	25.00		5.00	554.3	569.6	-2.76			
12	30.00		5.00	274.1	451.3	-64.61			
13	40.00		5.00	280.2	304.7	-8.74			
14	50.00		5.00	185.3	202.2	-22.37			
15	60.00		5.00	105.1	131.8	-25.46			
16	75.00		5.00	70.89	70.88	0.0219			
17	100.00		5.00	49.51	32.90	34.35			
18	125.00		5.00	43.61	22.68	47.99			
19	150.00		5.00	28.94	20.72	30.48			
20	175.00		5.00	22.11	19.33	12.55			
21	125.00		25.00	41.44	22.43	45.86			
22	150.00		25.00	27.89	19.65	29.54			
23	175.00		25.00	21.48	18.81	12.44			
24	200.00		25.00	23.50	18.48	21.34			
25	250.00		25.00	16.32	18.20	-11.49			
26	300.00		25.00	15.72	18.07	-14.95			

NO DATA ARE MASKED

Layered Model



SEV B-2 Buena Vista (Municipio de Riberalta)

SEV 1 BUENA VISTA

L #	RESISTIVITY	THICKNESS (meters)	DEPTH	ELEVATION (meters)	LONG. COND. TRANS. RES. (S/cm-m ²)
1	4789.3	1.01	1.01	-1.01	2.149E-04
2	7927.4	2.82	3.83	-3.83	3.563E-04
3	555.5	20.18	24.02	-24.02	0.0363
4	17.80				11213.8

ALL PARAMETERS ARE FREE

SEV 3 ROSARIO DEL YATA

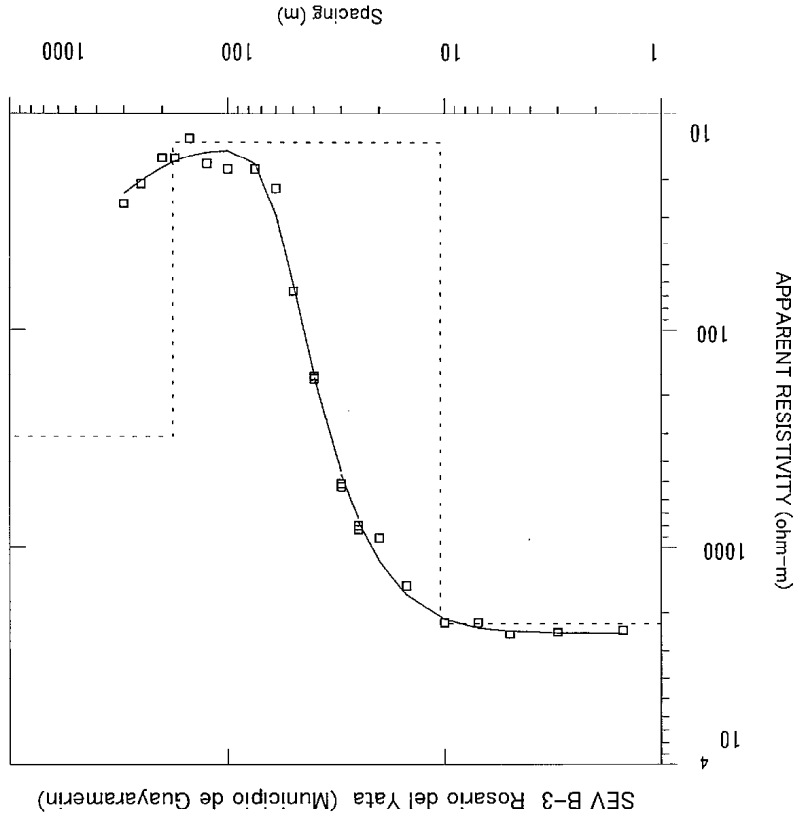
Schlumberger Array

Northing: 8782826.0 Easting: 218273.0 Elevation: 208.0

No.	Spacing (meters)	Layered Model:		Smooth Model:	
		AB/2	MN	Data Resistivity	Synthetic Resistivity
1	1.50	0.50	2400.0	2469.1	-2.88%
2	3.00	0.50	2456.0	2458.1	-0.09%
3	5.00	0.50	2517.0	2416	4.01%
4	7.00	0.50	2213.0	2332	-5.38%
5	10.00	0.50	2214.0	2129.9	3.80%
6	15.00	0.50	1504.0	1656.9	-10.17%
7	20.00	0.50	908.0	1167	-28.52%
8	25.00	0.50	833.0	767.4	7.88%
9	25.00	5.00	800.0	737	7.88%
10	30.00	0.50	528.0	463.5	12.22%
11	30.00	5.00	512.0	449.5	12.21%
12	40.00	0.50	170.0	167	1.76%
13	40.00	5.00	165.0	162	1.82%
14	50.00	5.00	67.0	62.47	6.76%
15	60.00	5.00	22.0	29.4	-33.64%
16	75.00	5.00	18.0	17.05	5.28%
17	100.00	5.00	18.0	14.9	17.22%
18	125.00	5.00	17.0	15.25	10.29%
19	125.00	25.00	17.0	15.25	10.29%
20	150.00	5.00	13.0	16.03	-23.31%
21	150.00	25.00	13.0	16.03	-23.31%
22	175.00	5.00	16.0	17.06	-6.62%
24	200.00	25.00	21.0	21.16	-0.76%
25	250.00	25.00	26.0	24.38	6.23%
26	300.00	25.00	68.2	65	4.66%

Layered Model

L #	Resistivity	Thickness	Depth
1	2233.0	10.46	10.46
2	13.5	157.3	167.76
3	310.7		



SEV 4 PRIMERO DE MAYO

Schlumberger Array

Northing: 8833032.0 Easting: 218693.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters)	AB/2	MN	Layered Model:			Smooth Model:		
				Data Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	DIFFERENCE
1	1.50	0.500	2042.4	2240.0	-9.67				
2	3.00	0.500	2815.5	2733.9	2.89				
3	5.00	0.500	3238.7	2980.7	7.96				
4	7.00	0.500	2862.8	2862.7	-6.70				
5	10.00	0.500	2441.0	2361.7	3.24				
6	15.00	0.500	1288.8	1430.8	-11.01				
7	20.00	0.500	768.4	804.9	-4.75				
8	25.00	0.500	616.4	472.2	23.39				
9	30.00	0.500	390.3	312.8	19.84				
10	40.00	0.500	218.6	207.1	5.23				
11	25.00	5.00	592.0	478.6	19.14				
12	30.00	5.00	362.1	313.8	13.34				
13	40.00	5.00	214.8	204.7	4.70				
14	50.00	5.00	162.6	181.6	-11.65				
15	60.00	5.00	165.5	17.53	-5.90				
16	75.00	5.00	178.0	172.0	3.38				
17	100.0	5.00	142.2	169.9	-19.45				
18	125.0	5.00	186.7	169.0	9.45				
19	150.0	5.00	213.2	168.5	20.93				
20	175.0	5.00	176.8	168.3	4.84				
21	125.0	25.00	177.7	164.7	7.33				
22	150.0	25.00	205.0	164.2	19.88				
23	175.0	25.00	172.2	163.9	4.83				
24	200.0	25.00	218.2	163.7	24.94				
25	250.0	25.00	246.4	163.5	33.84				
26	300.0	25.00	168.4	163.4	2.97				

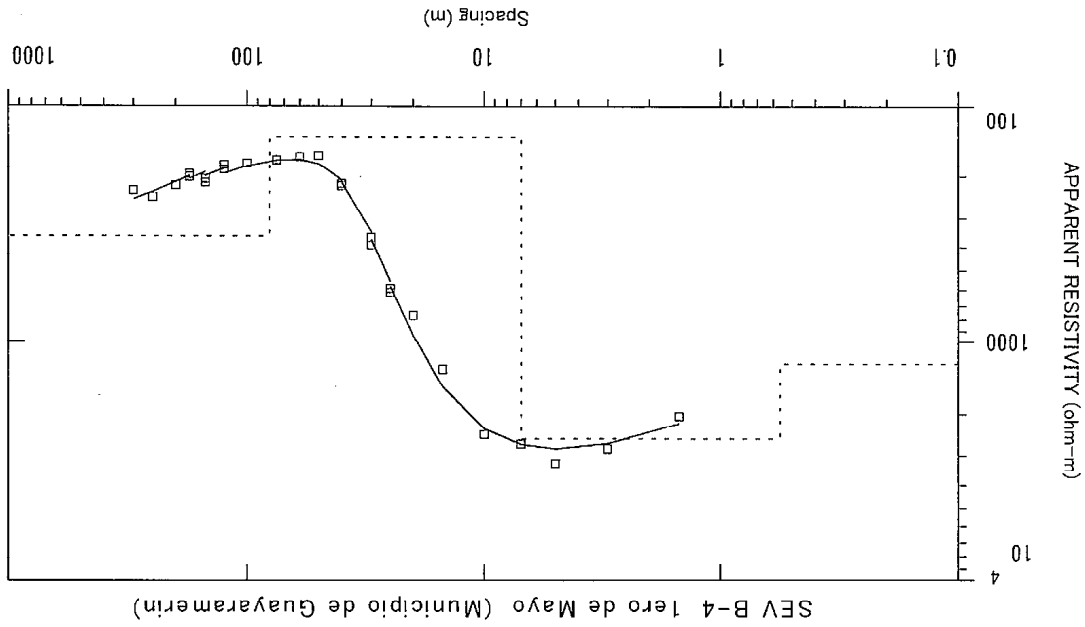
NO DATA ARE MASKED

Layered Model

SEV 3 1° DE MAYO

L #	RESISTIVITY	THICKNESS (meters)	DEPTH	ELEVATION (meters)	LONG. COND. TRANS. RES. (Siemens) (Ohm-m ²)
1	1900.6	1.06	1.06	-1.06	5.618E-04
2	3845.4	4.79	5.86	-5.86	0.00125
3	163.2				18447.7

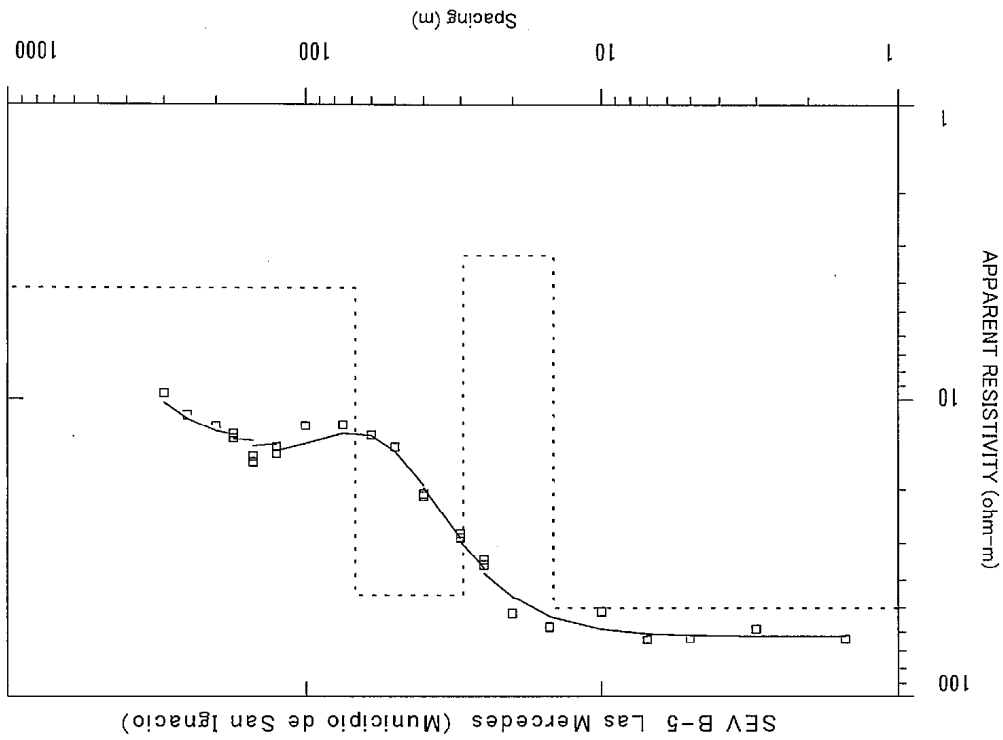
ALL PARAMETERS ARE FREE



SEV 5 LAS MERCEDES

Schlumberger Array

Northing: 8368929.0 Easting: 203994.0 Elevation: 0.0



No.	Spacing (meters)	AB/2	Layered Model:		Smooth Model:	
			Data Resistivity	Synthetic Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE
1	1.50	0.50	63.6	62.15	2.26%	
2	3.00	0.50	58.7	62.06	-5.80%	
3	5.00	0.50	63.4	61.69	2.68%	
4	7.00	0.50	63.8	60.94	4.45%	
5	10.00	0.50	51.5	58.91	-14.43%	
6	15.00	0.50	57.8	53.24	7.81%	
7	20.00	0.50	52.1	45.76	12.19%	
8	25.00	0.50	35.7	38	-6.38%	
9	25.00	5.00	34.3	36.44	-6.39%	
10	30.00	0.50	28.8	29.79	-3.33%	
11	30.00	5.00	28.0	28.96	-3.32%	
12	40.00	0.50	21.1	19.81	6.11%	
13	40.00	5.00	20.7	19.46	6.13%	
14	50.00	5.00	14.5	14.94	-3.32%	
15	60.00	5.00	13.1	13.2	-0.46%	
16	75.00	5.00	12.1	12.94	-6.68%	
17	100.00	5.00	12.2	14.02	-14.73%	
18	125.00	5.00	15.2	14.83	2.37%	
19	125.00	25.00	14.4	14.07	2.36%	
20	150.00	5.00	16.2	14.31	11.83%	
21	150.00	25.00	15.5	13.69	11.79%	
22	175.00	5.00	13.5	13.54	-0.67%	
23	175.00	25.00	13.0	13.09	-0.69%	
24	200.00	25.00	12.2	12.7	-4.10%	
25	250.00	25.00	11.3	11.54	-2.40%	
26	300.00	25.00	9.5	10.23	-7.23%	

Layered Model

L #	Resistivity	Thickness	Depth
1	49.9	14.53	14.53
2	3.3	14.86	29.39
3	45.1	38.57	67.96
4	4.17		

SEV 6 SAN JOAQUIN

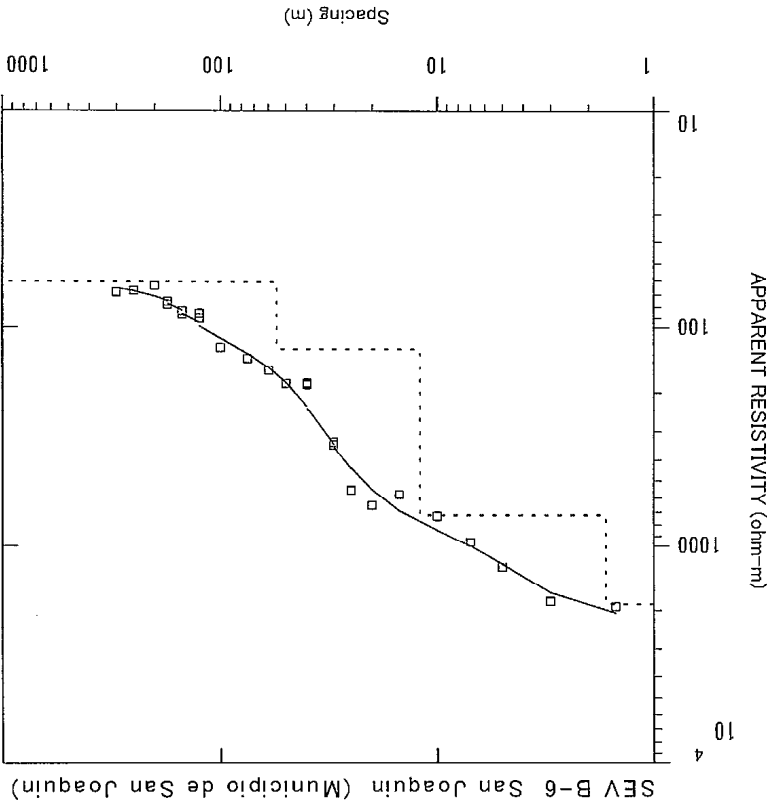
Schlumberger Array

Northing: 8556844.0 Easting: 319186.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters)	AB/2	MN	Layered Model:			Smooth Model:		
				Data Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	DIFFERENCE
1	1.50	0.50	1920.0	2057.7	-7.17%				
2	3.00	0.50	1823.1	1655.9	9.17%				
3	5.00	0.50	1260.8	1218.6	3.35%				
4	7.00	0.50	960.0	1000.7	-4.24%				
5	10.00	0.50	730.0	847.4	-16.08%				
6	15.00	0.50	580.0	689.7	-18.91%				
7	20.00	0.50	651.0	552.6	15.12%				
8	25.00	0.50	551.0	437.2	20.65%				
9	25.00	5.00	558.0	442.7	20.66%				
10	30.00	0.50	343.4	352.8	-2.74%				
11	30.00	5.00	333.7	342.8	-2.73%				
12	40.00	0.50	183.4	235.1	-28.19%				
13	40.00	5.00	180.2	231	-28.19%				
14	50.00	5.00	181.4	179.5	1.05%				
15	60.00	5.00	156.8	153	2.42%				
16	75.00	5.00	138.8	131.8	5.04%				
17	100.00	5.00	123.7	111.9	9.54%				
18	125.00	5.00	90.2	99.11	-9.91%				
19	125.00	25.00	85.7	94.22	-9.92%				
20	150.00	5.00	86.8	85.95	1.02%				
21	150.00	25.00	83.5	82.68	1.02%				
22	175.00	5.00	77.9	77.29	0.73%				
23	175.00	25.00	75.4	74.84	0.74%				
24	200.00	25.00	63.6	71.29	-12.13%				
25	250.00	25.00	66.9	67.14	-0.40%				
26	300.00	25.00	68.2	65	4.66%				

Layered Model

L #	Resistivity	Thickness	Depth
1	1870.0	1.66	1.66
2	721.0	10.34	12
3	125.0	42.99	54.99
4	60.95		



SEV 7 SAN JUAN DE AGUA DULCE

Schlumberger Array

Northing: 8460246.0 Easting: 325210.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters)	AB/2	MN	Layered Model:		Smooth Model:	
				Data Resistivity	Synthetic Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE
1	1.50	0.500	0.500	89.95	90.67	89.95	-0.808
2	3.00	0.500	0.500	166.7	157.3	166.7	5.58
3	5.00	0.500	0.500	233.4	210.0	233.4	9.99
4	7.00	0.500	0.500	206.3	230.6	206.3	-11.81
5	10.00	0.500	0.500	198.0	226.1	198.0	-14.20
6	15.00	0.500	0.500	219.2	183.2	219.2	16.41
7	20.00	0.500	0.500	144.1	138.5	144.1	3.89
8	25.00	0.500	0.500	103.2	104.7	103.2	-1.49
9	30.00	0.500	0.500	70.38	81.09	70.38	-15.21
10	40.00	0.500	0.500	52.26	52.20	52.26	0.128
11	25.00	5.00	5.00	99.09	103.7	99.09	-4.74
12	30.00	5.00	5.00	68.36	80.11	68.36	-17.18
13	40.00	5.00	5.00	51.11	51.37	51.11	-0.815
14	50.00	5.00	5.00	31.56	35.13	31.56	-1.30
15	60.00	5.00	5.00	22.12	25.04	22.12	-13.20
16	75.00	5.00	5.00	16.88	16.34	16.88	3.21
17	100.00	5.00	5.00	15.98	10.22	15.98	36.04
18	125.00	5.00	5.00	11.27	7.95	11.27	29.44
19	150.00	5.00	5.00	7.76	6.76	7.76	12.92
20	175.00	5.00	4.80	4.80	5.90	4.80	-22.92
21	125.00	25.00	10.71	10.71	7.56	10.71	29.40
22	150.00	25.00	7.41	7.41	6.40	7.41	13.70
23	175.00	25.00	4.52	4.52	5.58	4.52	-23.37
24	200.00	25.00	2.72	2.72	4.90	2.72	-80.18
25	250.00	25.00	2.72	2.72	3.82	2.72	-40.60
26	300.00	25.00	2.24	2.24	3.06	2.24	-36.23

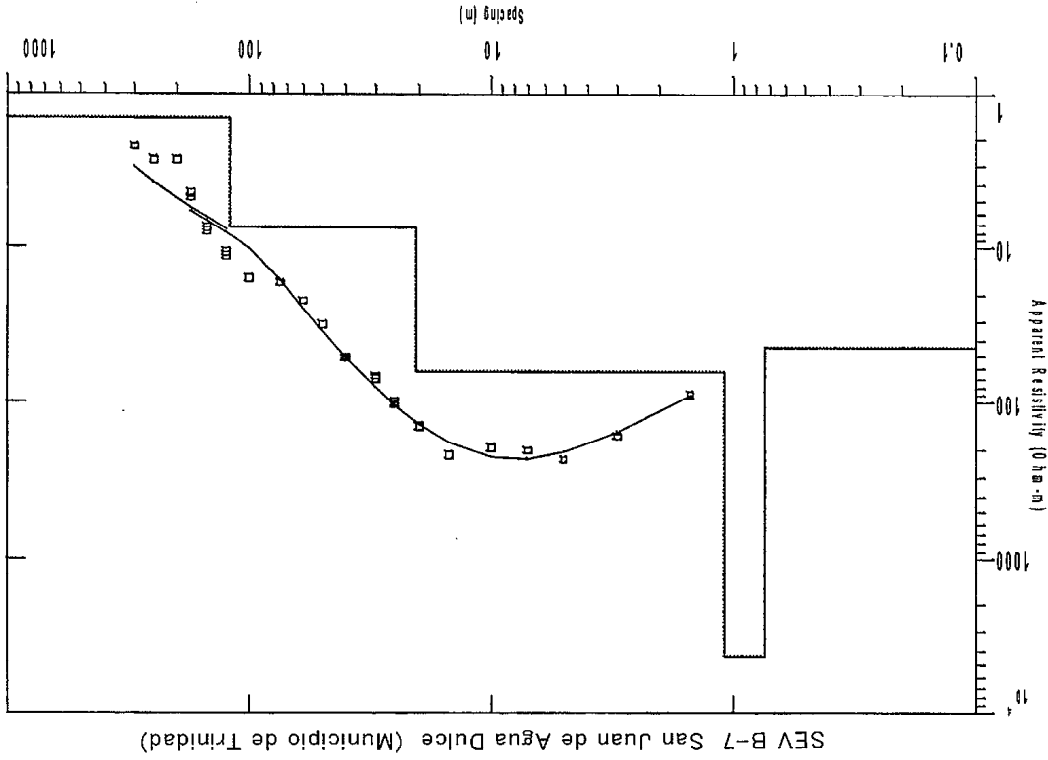
NO DATA ARE MASKED

Layered Model

SEV 21 SAN JUAN DE AGUA Page 2

L #	RESISTIVITY	THICKNESS (meters)	DEPTH	ELEVATION	LONG. COND. TRANS. RES. (Ohm-m ²)
1	44.21	0.735	0.735	0.0	0.0166
2	4377.1	0.353	1.08	-0.735	32.52
3	63.95	19.33	20.42	-1.08	8.075E-05
4	7.46	99.81	120.2	-20.42	1547.1
5	1.46			-120.2	1236.5
					0.302
					13.34
					746.8

ALL PARAMETERS ARE FREE



SEV B-7 San Juan de Agua Dulce (Municipio de Trinidad)

SEV 8 SAN JOSE

Schlumberger Array

Northing: 8417586.0 Easting: 675265.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters) AB/2	Data Resistivity MN	Layered Model:		Smooth Model:	
			Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE
1	1.50	0.500	544.6	584.0	-7.23	
2	3.00	0.500	665.2	668.5	-0.492	
3	5.00	0.500	795.4	803.9	-1.06	
4	7.00	0.500	1007.1	889.3	11.70	
5	10.00	0.500	900.7	914.3	-1.50	
6	15.00	0.500	780.6	803.0	-2.87	
7	20.00	0.500	598.6	642.7	-7.36	
8	25.00	0.500	540.5	504.1	6.73	
9	30.00	0.500	432.1	402.6	6.83	
10	40.00	0.500	294.0	288.6	1.82	
11	50.00	5.00	518.3	497.8	3.95	
12	30.00	5.00	417.9	396.9	5.02	
13	40.00	5.00	287.1	283.2	1.35	
14	50.00	5.00	219.8	235.1	-6.94	
15	60.00	5.00	207.5	213.6	-2.92	
16	75.00	5.00	195.1	198.0	-1.52	
17	100.0	5.00	198.3	182.7	7.87	
18	125.0	5.00	203.8	169.6	16.77	
19	150.0	5.00	194.1	157.4	18.92	
20	175.0	5.00	180.7	146.3	19.04	
21	125.0	25.00	193.7	165.3	14.66	
22	150.0	25.00	187.0	153.3	17.98	
23	175.0	25.00	175.6	142.5	18.87	
24	200.0	25.00	114.5	133.0	-16.15	
25	250.0	25.00	82.03	118.3	-44.28	
26	300.0	25.00	101.6	108.4	-6.71	

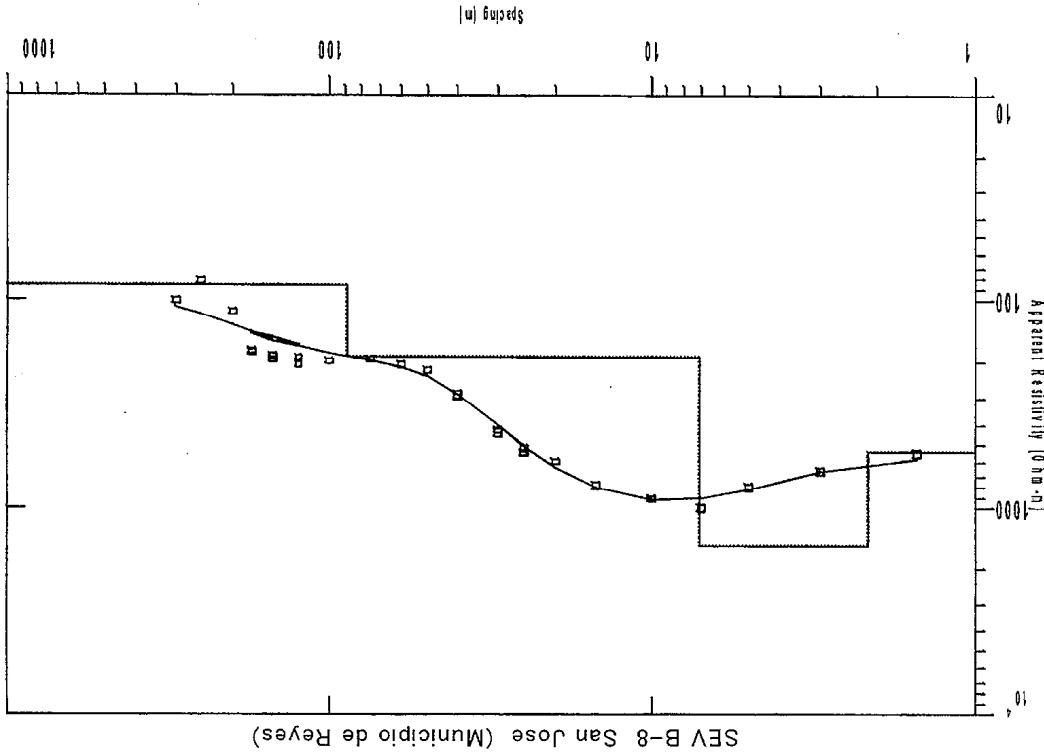
NO DATA ARE MASKED

Layered Model

SEV 8 SAN JOSE Page 2

L #	RESISTIVITY	THICKNESS (meters)	DEPTH (meters)	ELEVATION (meters)	LONG. COND. TRANS. RES. (Ohm-m ²)
1	536.2	2.14	2.14	-2.14	0.00400
2	1547.2	4.99	7.13	-7.13	0.00323
3	190.0	81.94	89.08	-89.08	0.431
4	85.62				13576.1

ALL PARAMETERS ARE FREE



SEV 9 LA ARGENTINA

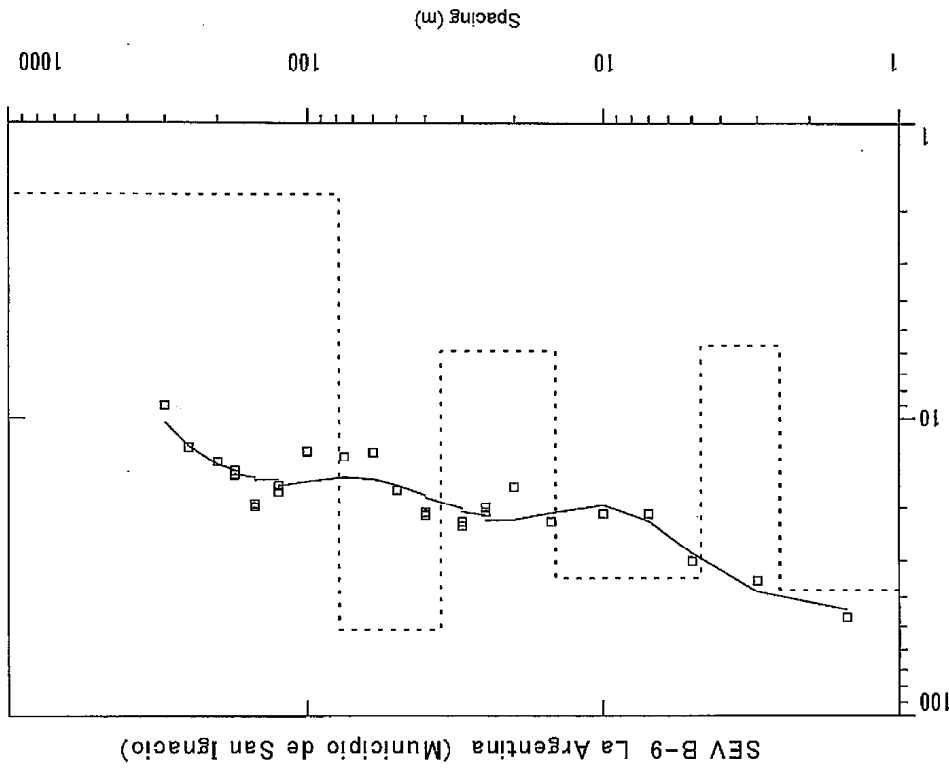
Schlumberger Array

Northing: 8359348.0 Easting: 249728.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters)	AB/2	MN	Layered Model:		Smooth Model:	
				Data Resistivity	Synthetic Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE
1	1.50		0.50	46.7	44.15	5.40%	
2	3.00		0.50	35.0	36.24	-9.19%	
3	5.00		0.50	30.0	28.3	5.67%	
4	7.00		0.50	21.0	22.15	-5.73%	
5	10.00		0.50	20.9	19.6	6.13%	
6	15.00		0.50	22.2	20.83	6.34%	
7	20.00		0.50	17.0	21.91	-29.26%	
8	25.00		0.50	20.6	21.97	-6.65%	
9	25.00		5.00	19.8	21.13	-6.66%	
10	30.00		0.50	22.9	20.59	10.05%	
11	30.00		5.00	22.3	20.02	10.06%	
12	40.00		0.50	21.1	18.41	12.75%	
13	40.00		5.00	20.7	18.05	12.72%	
14	50.00		5.00	17.3	16.71	3.58%	
15	60.00		5.00	12.9	15.94	-23.47%	
16	75.00		5.00	13.4	15.68	-17.28%	
17	100.00		5.00	12.8	16.26	-26.64%	
18	125.00		5.00	17.6	16.8	4.76%	
19	125.00		25.00	16.8	15.96	4.77%	
20	150.00		5.00	19.8	16.02	18.97%	
21	150.00		25.00	19.4	15.7	18.95%	
22	175.00		5.00	15.4	15.31	0.46%	
23	175.00		25.00	14.9	14.82	0.47%	
24	200.00		25.00	13.9	14.14	-2.09%	
25	250.00		25.00	12.4	12.29	1.21%	
26	300.00		25.00	9.0	10.28	-14.48%	

Layered Model

L #	Resistivity	Thickness	Depth
1	37.6	2.52	2.52
2	5.6	2.14	4.66
3	34.2	9.83	14.49
4	5.90	20.89	35.38
5	51.13	42.68	78.06
6	1.75		



SEV 10 SAN JOAQUIN DEL MANIQUI

Schlumberger Array

Northing: 841770.0 Easting: 220681.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters) AB/2	MN	Layered Model:		Smooth Model:	
			Data Resistivity	Synthetic Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE
1	1.50	0.500	486.8	592.8	-21.77	
2	3.00	0.500	697.8	574.8	17.82	
3	5.00	0.500	504.0	433.2	14.03	
4	7.00	0.500	167.4	299.0	-78.59	
5	10.00	0.500	133.8	182.4	-36.37	
6	15.00	0.500	142.4	118.8	16.57	
7	20.00	0.500	115.6	102.2	11.59	
8	25.00	0.500	140.1	93.94	32.96	
9	30.00	0.500	92.71	86.82	6.35	
10	40.00	0.500	80.91	72.41	10.50	
11	25.00	5.00	134.5	92.65	31.13	
12	30.00	5.00	90.02	85.56	4.95	
13	40.00	5.00	79.56	71.35	10.31	
14	50.00	5.00	41.59	57.45	-38.12	
15	60.00	5.00	29.98	45.17	-50.64	
16	75.00	5.00	26.74	31.01	-15.97	
17	100.00	5.00	24.75	17.50	29.27	
18	125.00	5.00	18.62	11.60	37.66	
19	150.00	5.00	13.41	9.06	32.45	
20	175.00	5.00	10.57	7.83	25.91	
21	125.00	25.00	17.99	11.83	34.20	
22	150.00	25.00	13.32	9.14	31.41	
23	175.00	25.00	10.55	7.85	25.54	
24	200.00	25.00	6.43	7.11	-10.54	
25	250.00	25.00	4.66	6.10	-30.90	
26	300.00	25.00	3.93	5.31	-35.29	

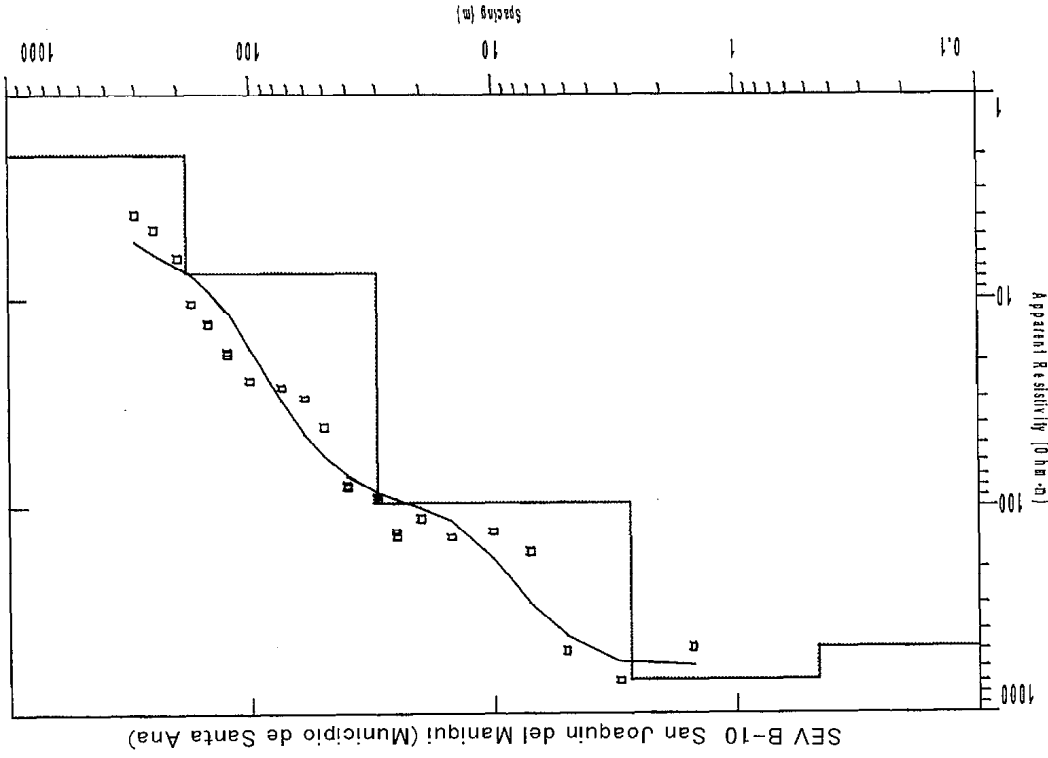
NO DATA ARE MASKED

Layered Model

SEV 10 S. JOAQUIN DE MAN

L #	RESISTIVITY	THICKNESS (meters)	DEPTH	ELEVATION (meters)	LONG. COND. TRANS. RES. (Ohm-m ²)
1	481.8	0.456	0.456	0.0	9.476E-04
2	695.8	2.26	2.71	-0.456	220.0
3	97.53	27.63	30.35	-2.71	0.00325
4	7.63	153.8	184.2	-30.35	2695.0
5	2.02			-184.2	21.14
					1175.3

ALL PARAMETERS ARE FREE



SEV 11 TUMICHUCUA

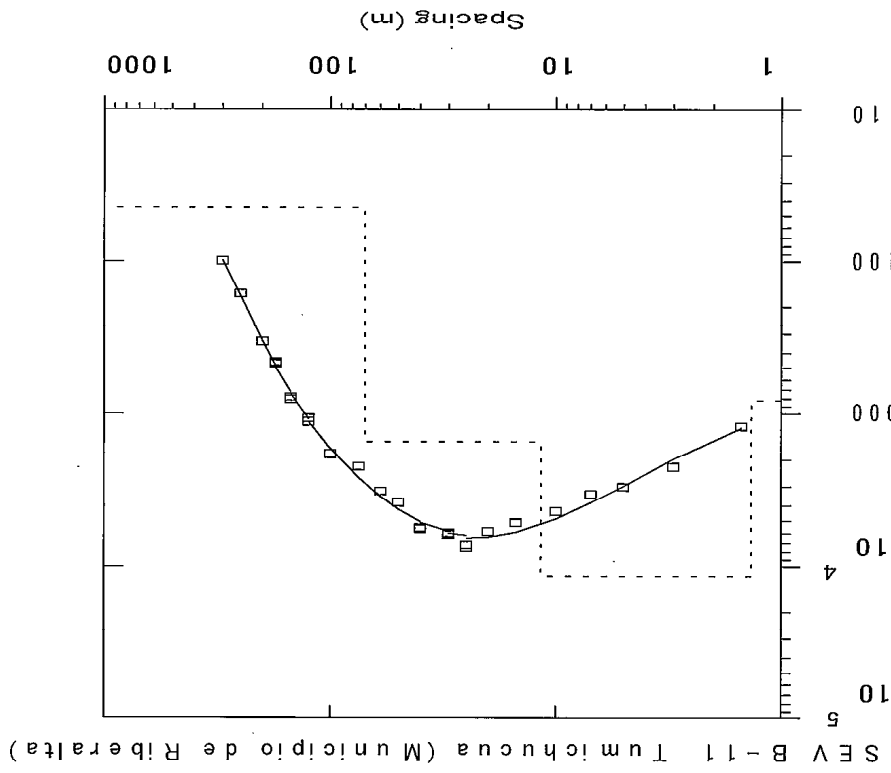
Schlumberger Array

Northing: 8766498.0 Easting: 809526.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters)	AB/2	MN	Layered Model:			Smooth Model:		
				Data Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	DIFFERENCE
1	1.50		0.50	1220.0	1241.6	-1.77%			
2	3.00		0.50	2231.0	1969.9	11.70%			
3	5.00		0.50	3022.0	2971.4	1.67%			
4	7.00		0.50	3376.0	3812.2	-12.92%			
5	10.00		0.50	4361.0	4782.3	-9.66%			
6	15.00		0.50	5168.0	5751.9	-11.30%			
7	20.00		0.50	5864.0	6115.2	-4.28%			
8	25.00		0.50	7480.0	6079.3	18.73%			
9	25.00		5.00	7183.0	5837.9	18.73%			
10	30.00		0.50	6147.0	5574.3	9.32%			
11	30.00		5.00	5978.0	5421	9.32%			
12	40.00		0.50	5648.0	4625.4	18.11%			
13	40.00		5.00	5599.0	4552.5	18.11%			
14	50.00		5.00	3813.0	3727.8	2.23%			
15	60.00		5.00	3211.0	3016.2	6.07%			
16	75.00		5.00	2204.0	2205.5	-0.07%			
17	100.00		5.00	1829.0	1355.9	25.87%			
18	125.00		5.00	1133.0	858.4	24.24%			
19	125.00		25.00	1078.0	816.7	24.24%			
20	150.00		5.00	809.0	522.9	35.36%			
21	150.00		25.00	779.0	503.5	35.37%			
22	175.00		5.00	472.0	325.6	31.02%			
23	175.00		25.00	459.0	316.6	31.02%			
24	200.00		25.00	338.0	209.1	38.14%			
25	250.00		25.00	163.0	104.4	35.95%			
26	300.00		25.00	99.4	67.4	32.19%			

Layered Model

L #	Resistivity	Thickness	Depth
1	37.6	2.52	2.52
2	5.6	2.14	4.66
3	34.2	9.83	14.49
4	5.90	20.89	35.38
5	51.13	42.68	78.06
6	1.75		



SEV 12 VILLA FATIMA

Schlumberger Array

Northing: 846034.0 Easting: 740865.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters)	AB/2	Data		Layered Model:		Smooth Model:	
			Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	
1	1.50	0.500	238.9	168.1	29.63			
2	3.00	0.500	35.67	39.72	-11.35			
3	5.00	0.500	29.02	25.33	12.71			
4	7.00	0.500	28.17	23.80	15.51			
5	10.00	0.500	24.86	22.30	10.30			
6	15.00	0.500	18.92	19.27	-1.83			
7	20.00	0.500	14.44	15.90	-10.10			
8	25.00	0.500	14.72	12.85	12.66			
9	30.00	0.500	9.32	10.46	-12.17			
10	40.00	0.500	6.03	7.63	-26.61			
11	25.00	5.00	13.96	12.24	12.36			
12	30.00	5.00	8.85	9.95	-12.43			
13	40.00	5.00	5.69	7.23	-27.22			
14	50.00	5.00	4.04	6.27	-55.11			
15	60.00	5.00	4.60	6.23	-35.34			
16	75.00	5.00	4.04	6.94	-71.73			
17	100.00	5.00	5.64	8.82	-56.47			
18	125.00	5.00	7.84	10.89	-38.97			
19	150.00	5.00	10.59	12.98	-22.60			
20	175.00	5.00	12.49	15.05	-20.48			
21	125.00	25.00	7.91	11.27	-42.45			
22	150.00	25.00	10.16	13.45	-32.33			
23	175.00	25.00	13.00	15.62	-20.09			
24	200.00	25.00	11.62	17.76	-52.74			
25	250.00	25.00	25.66	21.96	14.39			
26	300.00	25.00	28.64	26.07	8.94			

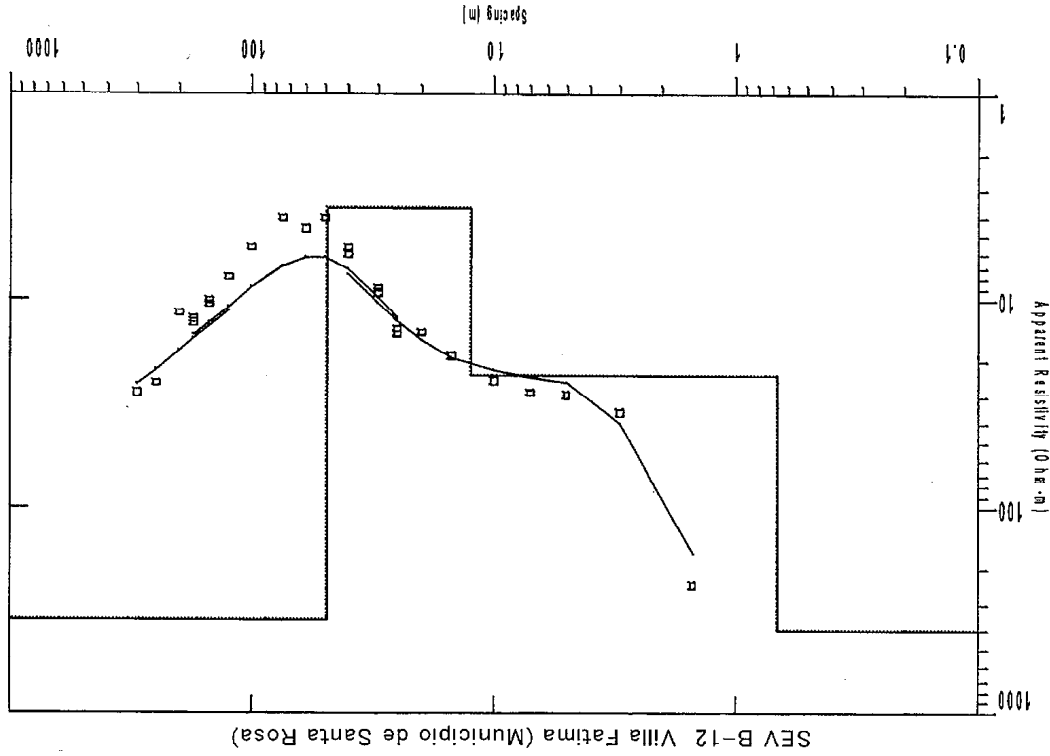
NO DATA ARE MASKED

Layered Model

SEV 7 VILLA FATIMA

L #	RESISTIVITY	THICKNESS (meters)	DEPTH	ELEVATION (meters)	LONG. COND. TRANS. RES. (Ohm-m ²)	RESISTIVITY (Ohm-m)
1	399.4	0.663	0.663	0.0	0.00166	265.0
2	23.37	11.82	12.48	-0.663	0.505	276.4
3	3.61	36.85	49.34	-12.48	10.20	133.1
4	357.7					

ALL PARAMETERS ARE FREE



SEV 13 SANTA ROSITA EL COZAR

Schlumberger Array

Northing: 8414655.0 Easting: 674237.0 Elevation: 0.0

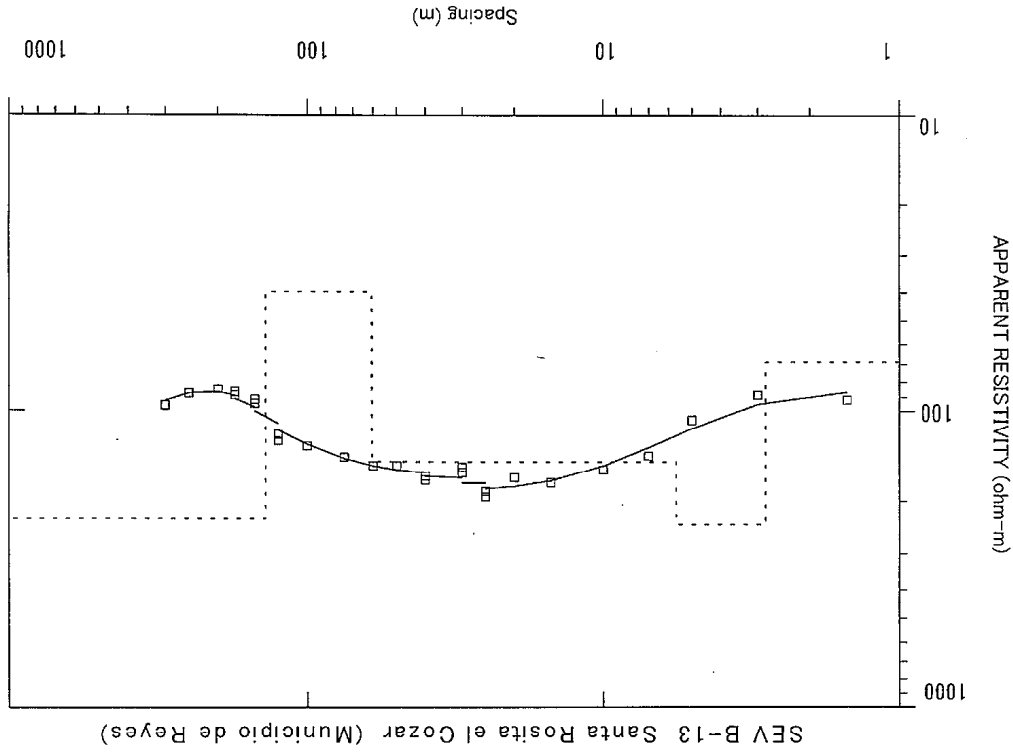
No.	Spacing (meters)	AB/2	M/N	Layered Model:			Smooth Model:		
				Data Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	DIFFERENCE
1	1.50	0.500	180.4	132.8	26.38				
2	3.00	0.500	88.86	104.2	-17.58				
3	5.00	0.500	107.3	107.3	-0.0788				
4	7.00	0.500	141.5	124.7	11.88				
5	10.00	0.500	157.5	147.5	6.31				
6	15.00	0.500	172.8	167.8	2.87				
7	20.00	0.500	166.5	174.3	-4.69				
8	25.00	0.500	193.3	174.2	9.84				
9	30.00	0.500	160.5	171.4	-6.76				
10	40.00	0.500	169.3	163.1	3.68				
11	50.00	5.00	185.0	169.7	8.27				
12	30.00	5.00	154.1	167.0	-8.31				
13	40.00	5.00	164.9	158.9	3.63				
14	50.00	5.00	152.5	150.6	1.22				
15	60.00	5.00	152.5	142.8	6.30				
16	75.00	5.00	142.8	132.0	7.58				
17	100.0	5.00	130.9	115.9	11.51				
18	125.0	5.00	125.4	103.1	17.80				
19	150.0	5.00	72.72	94.26	-29.62				
20	175.0	5.00	61.52	89.15	-44.91				
21	225.0	25.00	119.2	100.9	15.33				
22	150.0	25.00	69.24	92.17	-33.10				
23	175.0	25.00	59.94	87.06	-45.24				
24	200.0	25.00	62.09	85.07	-37.00				
25	250.0	25.00	84.36	87.87	-4.15				
26	300.0	25.00	90.97	96.31	-5.66				

NO DATA ARE MASKED

Layered Model

L #	RESISTIVITY	THICKNESS (meters)	DEPTH	ELEVATION	LONG. COND. TRANS. RES. (Siemens)	RES. (Ohm-m ²)
1	146.7	1.01	1.01	-1.01	0.00691	146.7
2	62.91	2.22	3.23	-3.23	0.0353	139.9
3	391.5	3.43	6.67	-6.67	0.00878	1346.0
4	141.3	49.58	56.26	-56.26	0.350	7010.9
5	50.33	145.0	201.2	-201.2	2.88	7299.0
6	4982.9					

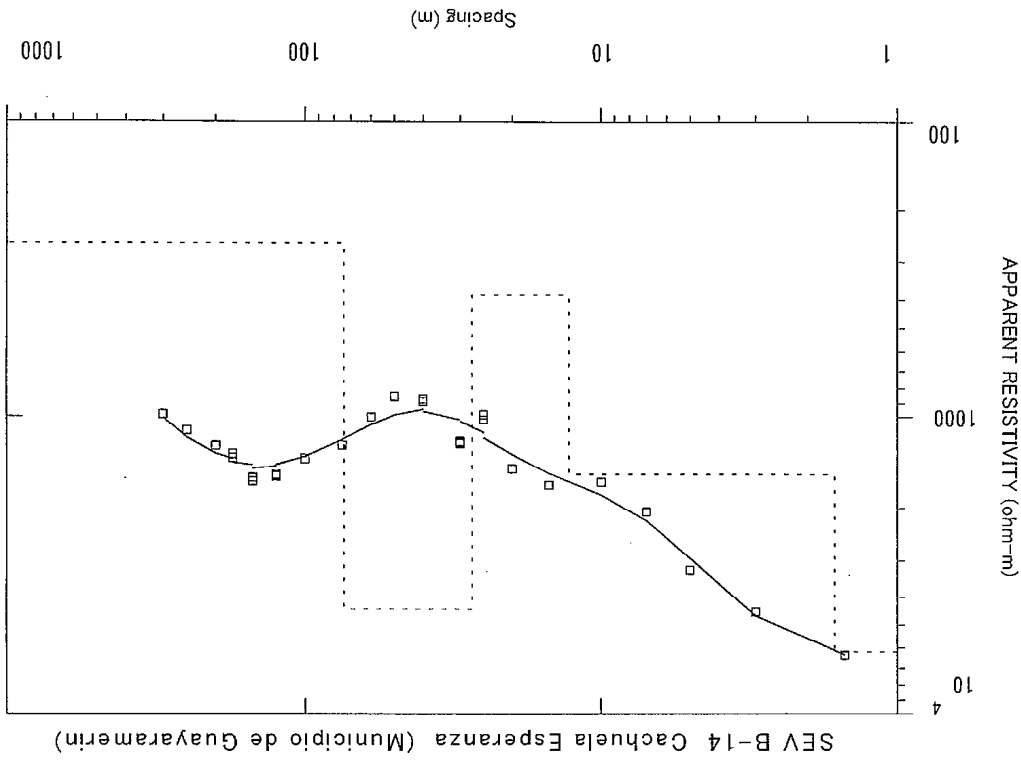
ALL PARAMETERS ARE FREE



SEV 14 CACHUELA ESPERANZA

Schlumberger Array

Northing: 8833032.0 Easting: 218693.0 Elevation: 0.0



SEV B-14 Cachuela Esperanza (Municipio de Guayaramerin)

No.	Spacing (meters)	AB/2	Layered Model:			Smooth Model:		
			Data Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	DIFFERENCE
1	1.50	0.50	6327.0	6335.6	-0.14%			
2	3.00	0.50	4498.0	4632.7	-2.99%			
3	5.00	0.50	3228.0	2932.4	9.16%			
4	7.00	0.50	2060.0	2204	-6.99%			
5	10.00	0.50	1641.0	1812.6	-10.46%			
6	15.00	0.50	1682.0	1537.9	8.57%			
7	20.00	0.50	1486.0	1336	10.09%			
8	25.00	0.50	1025.5	1181.3	-15.19%			
9	25.00	5.00	984.0	1133.5	-15.19%			
10	30.00	5.00	1228.0	1036.4	15.60%			
11	30.00	5.00	1212.0	1022.9	15.60%			
12	40.00	5.00	889.0	960.6	-8.05%			
13	40.00	5.00	874.0	944.4	-8.05%			
14	50.00	5.00	858.0	985.4	-14.85%			
15	60.00	5.00	1004.0	1065.7	-6.15%			
16	75.00	5.00	1246.0	1193.9	4.18%			
17	100.00	5.00	1380.0	1354.6	1.84%			
18	125.00	5.00	1550.0	1437.6	7.25%			
19	125.00	25.00	1570.0	1456.1	7.25%			
20	150.00	5.00	1630.0	1477.3	9.37%			
21	150.00	25.00	1590.0	1441	9.37%			
22	175.00	5.00	1370.0	1417.6	-3.47%			
23	175.00	25.00	1330.0	1376.2	-3.47%			
24	200.00	25.00	1250.0	1324.5	-5.96%			
25	250.00	25.00	1113.0	1176.5	-5.62%			
26	300.00	25.00	980.0	1009.2	-2.98%			

Layered Model

L #	Resistivity	Thickness	Depth
1	6157.0	1.62	1.62
2	1544.0	11.21	12.83
3	387.0	154.5	167.33
4	4389.00	46.64	213.97
5	259.00		

SEV 15 CARMEN DEL MATTO

Schlumberger Array

Northing: -999.0 Easting: -999.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters) AB/2 MN	Layered Model:		Smooth Model:	
		Data Resistivity	Synthetic Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE
1	1.50	949.7	873.4	8.03	
2	3.00	238.7	224.4	5.36	
3	5.00	89.64	85.79	4.29	
4	7.00	65.25	73.05	-11.94	
5	10.00	66.16	67.94	-2.66	
6	15.00	71.03	59.89	15.67	
7	20.00	57.89	50.88	12.10	
8	25.00	42.19	42.32	-0.300	
9	30.00	28.83	35.16	-21.94	
10	40.00	23.11	25.63	-10.66	
11	25.00	46.47	41.80	-3.29	
12	30.00	27.98	34.70	-24.01	
13	40.00	22.66	25.24	-11.33	
14	50.00	15.62	20.57	-31.63	
15	60.00	13.25	18.58	-40.24	
16	75.00	15.12	17.82	-17.82	
17	100.0	20.05	18.31	8.67	
18	125.0	5.00	23.52	18.86	
19	150.0	5.00	26.41	19.74	
20	175.0	5.00	23.07	20.25	
21	125.0	25.00	22.32	16.52	
22	150.0	25.00	24.45	19.17	
23	175.0	25.00	22.43	19.67	
24	200.0	25.00	18.80	20.07	
25	250.0	25.00	18.66	20.63	
26	300.0	25.00	20.21	20.99	

NO DATA ARE MASKED

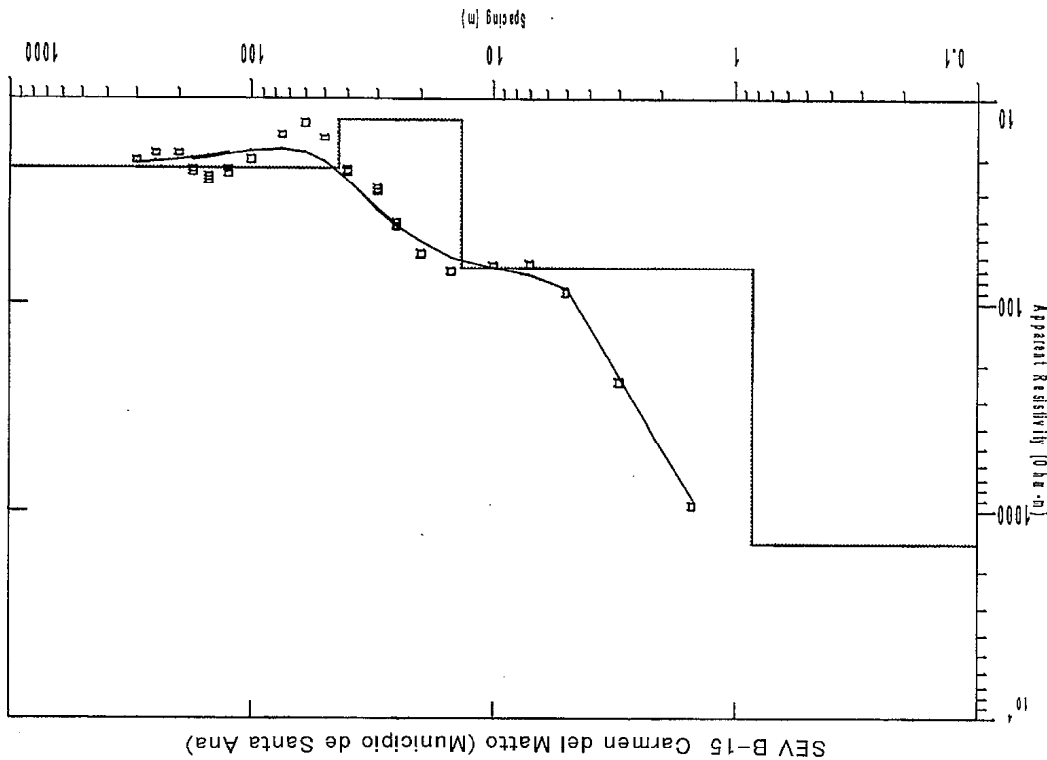
Layered Model

SEV 12 CARMEN DEL MATTO

Page 2

L #	RESISTIVITY	THICKNESS (meters)	DEPTH	ELEVATION	LONG. COND.	TRANS. RES. (Ohm-m ²)
1	1458.7	0.849	0.849	-0.849	5.825E-04	1239.4
2	67.31	12.59	13.44	-13.44	0.187	848.0
3	12.65	30.23	43.68	-43.68	2.38	382.7
4	22.13					

ALL PARAMETERS ARE FREE



SEV 16 SIETE ESQUINAS

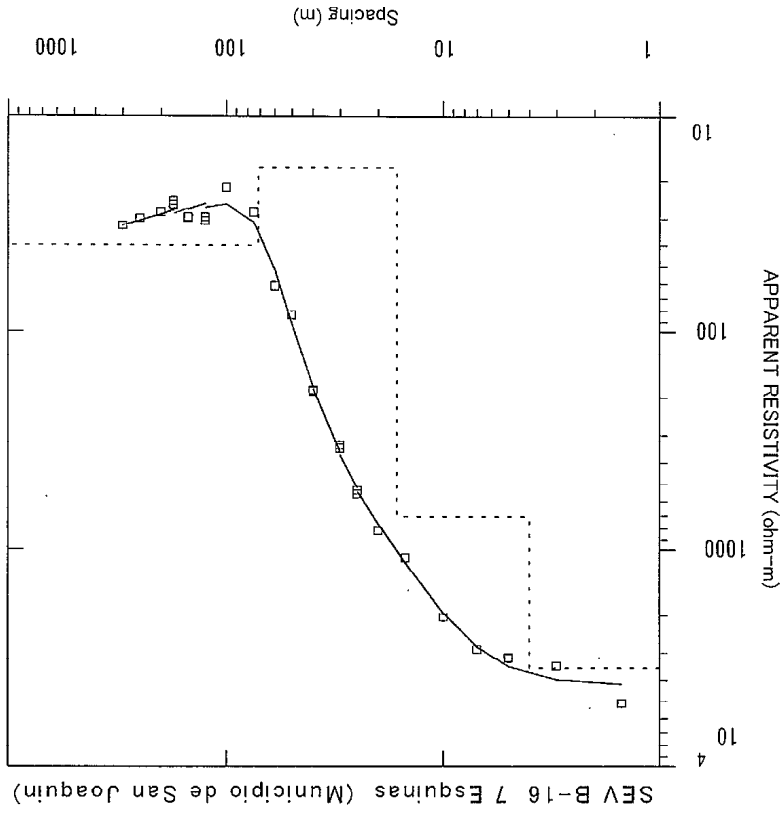
Schlumberger Array

Northing: 8590266.0 Easting: 307886.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters)	AB/2	MN	Layered Model:			Smooth Model:		
				Data Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	DIFFERENCE
1	1.50		0.50	5100.0	4177.2	18.09%			
2	3.00		0.50	3440.0	3986.4	-15.88%			
3	5.00		0.50	3155.0	3456.7	-9.56%			
4	7.00		0.50	2878.0	2800.3	2.70%			
5	10.00		0.50	2038.0	1953.4	4.15%			
6	15.00		0.50	1086.0	1144.5	-5.39%			
7	20.00		0.50	819.0	763.6	6.76%			
8	25.00		0.50	557.0	541.4	2.80%			
9	25.00		5.00	535.0	520.1	2.79%			
10	30.00		0.50	347.0	372.3	-7.29%			
11	30.00		5.00	336.0	360.5	-7.29%			
12	40.00		0.50	188.0	181.8	3.30%			
13	40.00		5.00	185.0	178.9	3.30%			
14	50.00		5.00	84.1	91.78	-9.13%			
15	60.00		5.00	62.0	52.16	15.87%			
16	75.00		5.00	59.0	31.18	47.15%			
17	100.00		5.00	51.7	25.76	50.17%			
18	125.00		5.00	30.9	26.77	13.37%			
19	125.00		25.00	29.6	25.65	13.34%			
20	150.00		5.00	30.1	27.26	9.44%			
21	150.00		25.00	29.7	26.9	9.43%			
22	175.00		5.00	26.0	28.42	-9.31%			
23	175.00		25.00	25.0	27.33	-9.32%			
24	200.00		25.00	28.0	28.64	-2.29%			
25	250.00		25.00	30.0	30.77	-2.57%			
26	300.00		25.00	32.6	32.39	0.64%			

Layered Model

L #	Resistivity	Thickness	Depth
1	3502.0	3.99	3.99
2	706.0	12.42	16.41
3	17.2	54.84	71.25
4		40.20	



SEV 17 CARMEN DEL IRUYANEZ

Schlumberger Array

Northing: 8517098.0 Easting: 218186.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters)	AB/2	MN	Layered Model:			Smooth Model:		
				Data Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	
1	1.50	0.500	3928.8	3712.8	5.49				
2	3.00	0.500	1927.8	2005.3	-4.02				
3	5.00	0.500	1160.4	1043.8	1.55				
4	7.00	0.500	933.6	800.8	14.22				
5	10.00	0.500	703.7	680.5	3.29				
6	15.00	0.500	483.5	535.3	-10.72				
7	20.00	0.500	339.9	397.4	-16.91				
8	25.00	0.500	272.0	283.9	-4.38				
9	30.00	0.500	197.3	201.2	-1.98				
10	40.00	0.500	129.1	109.1	15.47				
11	50.00	0.500	260.8	281.5	-7.92				
12	60.00	0.500	191.1	199.2	-4.27				
13	80.00	0.500	126.0	107.6	14.38				
14	100.00	0.500	94.93	71.13	25.07				
15	150.00	0.500	71.87	57.14	20.49				
16	200.00	0.500	68.08	49.89	26.72				
17	300.00	0.500	31.65	45.71	-44.42				
18	400.00	0.500	45.57	42.73	6.23				
19	500.00	0.500	40.95	39.65	3.16				
20	750.00	0.500	32.68	36.43	-11.46				
21	1000.00	0.500	43.61	41.73	4.30				
22	1500.00	0.500	39.84	38.72	2.80				
23	2000.00	0.500	31.85	35.58	-11.69				
24	3000.00	0.500	33.15	32.38	2.32				
25	4000.00	0.500	26.04	26.28	-0.890				
26	5000.00	0.500	17.40	21.07	-21.03				

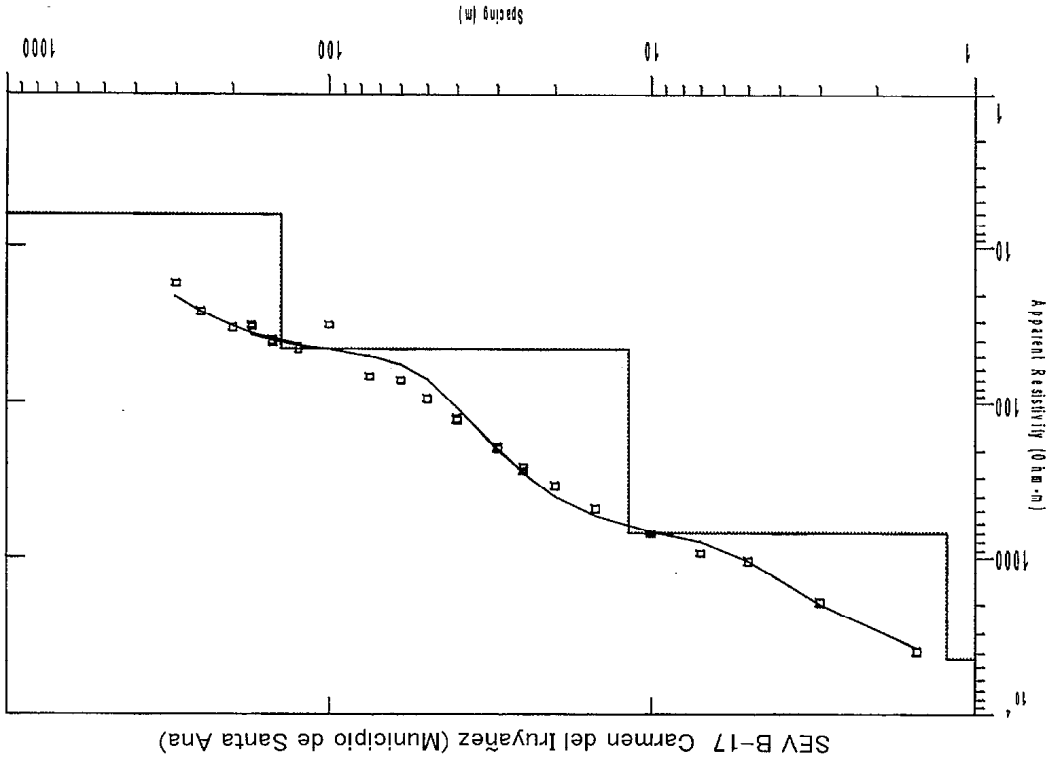
NO DATA ARE MASKED

Layered Model

SEV 18 CARMEN DE IRUYANEZ

L #	RESISTIVITY	THICKNESS (meters)	DEPTH	ELEVATION (meters)	LONG. COND. TRANS. RES. (Siemens) (Ohm-m ²)
1	4323.6	1.20	1.20	0.0	5228.1
2	691.5	10.48	11.69	-1.20	2.707E-04
3	45.58	129.4	141.1	-11.69	0.0151
4	6.10			-141.1	2.83

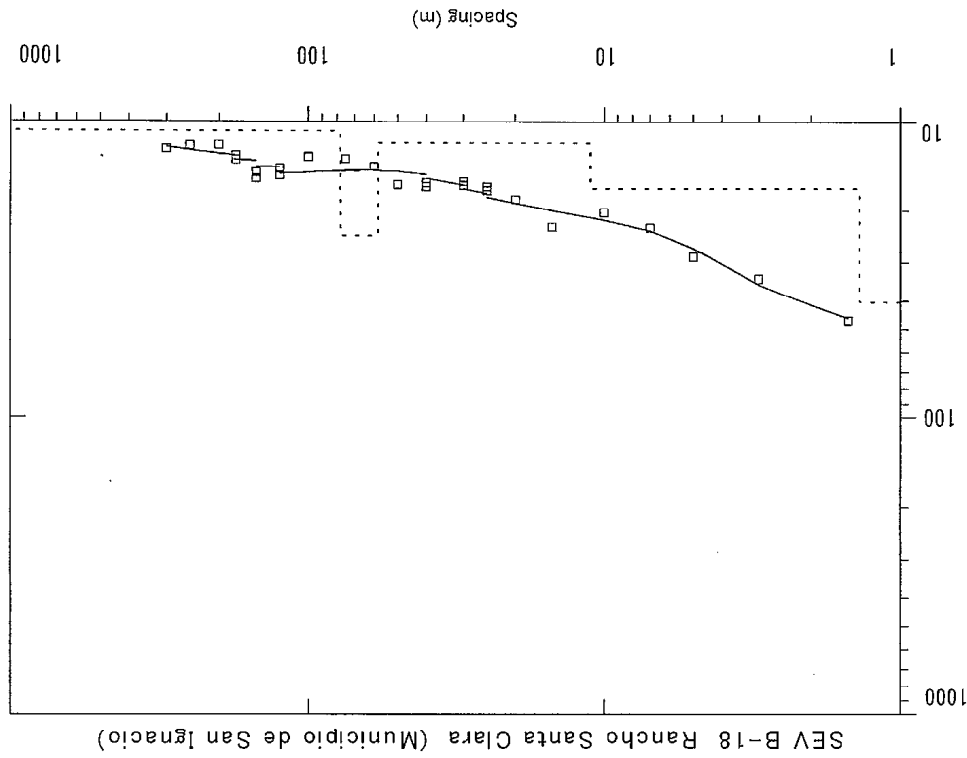
ALL PARAMETERS ARE FREE



SEV 18 RANCHON SANTA CLARA

Schlumberger Array

Northing: 8319529.0 Easting: 3206186.0 Elevation: 0.0



No.	Spacing (meters)	AB/2	MN	Layered Model:			Smooth Model:		
				Data Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	
1	1.50		0.50	66.9	45.63	31.75%			
2	3.00		0.50	33.9	35.29	-4.19%			
3	5.00		0.50	28.7	26.66	6.98%			
4	7.00		0.50	22.9	23.24	-1.44%			
5	10.00		0.50	20.3	21.3	-4.82%			
6	15.00		0.50	22.8	19.84	12.98%			
7	20.00		0.50	18.3	18.79	-2.51%			
8	25.00		0.50	17.1	17.93	-4.85%			
9	25.00		5.00	16.4	17.16	-4.70%			
10	30.00		0.50	16.6	16.52	0.36%			
11	30.00		5.00	16.6	15.86	4.46%			
12	40.00		0.50	15.9	15.07	5.28%			
13	40.00		5.00	16.1	14.68	8.71%			
14	50.00		5.00	16.3	14.3	12.38%			
15	60.00		5.00	14.2	14.15	0.35%			
16	75.00		5.00	13.4	14.15	-5.85%			
17	100.00		5.00	13.2	14.35	-9.04%			
18	125.00		5.00	15.2	14.54	4.28%			
19	125.00		25.00	15.5	13.83	10.95%			
20	150.00		5.00	13.5	13.88	-3.20%			
21	150.00		25.00	14.4	13.45	6.66%			
22	175.00		5.00	14.8	13.38	9.78%			
23	175.00		25.00	13.0	13.08	-0.62%			
24	200.00		25.00	12.0	12.92	-7.31%			
25	250.00		25.00	12.1	12.47	-3.49%			
26	300.00		25.00	12.4	11.97	3.08%			

Layered Model

L #	Resistivity	Thickness	Depth
1	40.0	1.4	1.4
2	16.6	10.19	11.59
3	11.8	56.97	68.56
4	28.76	24.53	93.09
5	9.44		

SEV 19 VILLA GONZALES

Schlumberger Array

Northing: 8353306.0 Easting: 747371.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters)	AB/2	MN	Data		Layered Model:		Smooth Model:	
				Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	
1	1.50	0.500	329.6	274.9	16.39				
2	3.00	0.500	338.8	375.3	-10.78				
3	5.00	0.500	674.4	471.4	30.40				
4	7.00	0.500	510.2	492.1	3.55				
5	10.00	0.500	406.0	441.1	-8.64				
6	15.00	0.500	231.2	296.1	-28.94				
7	20.00	0.500	190.6	184.3	3.31				
8	25.00	0.500	110.6	116.1	-4.95				
9	30.00	0.500	66.42	80.14	-20.64				
10	40.00	0.500	69.85	63.73	23.03				
11	25.00	5.00	106.1	115.7	-9.05				
12	30.00	5.00	63.52	79.27	-24.78				
13	40.00	5.00	67.88	52.50	22.63				
14	50.00	5.00	37.78	46.49	-23.02				
15	60.00	5.00	40.54	45.07	-11.17				
16	75.00	5.00	37.12	44.57	-20.07				
17	100.00	5.00	47.94	44.37	7.44				
18	125.00	5.00	55.37	44.31	19.99				
19	150.00	5.00	50.13	44.28	11.67				
20	175.00	5.00	52.87	44.26	16.28				
21	125.00	25.00	52.94	43.28	18.23				
22	150.00	25.00	48.63	43.25	11.08				
23	175.00	25.00	51.64	43.23	16.28				
24	200.00	25.00	45.76	43.22	5.55				
25	250.00	25.00	47.04	43.21	8.13				
26	300.00	25.00	42.68	43.21	-1.23				

NO DATA ARE MASKED

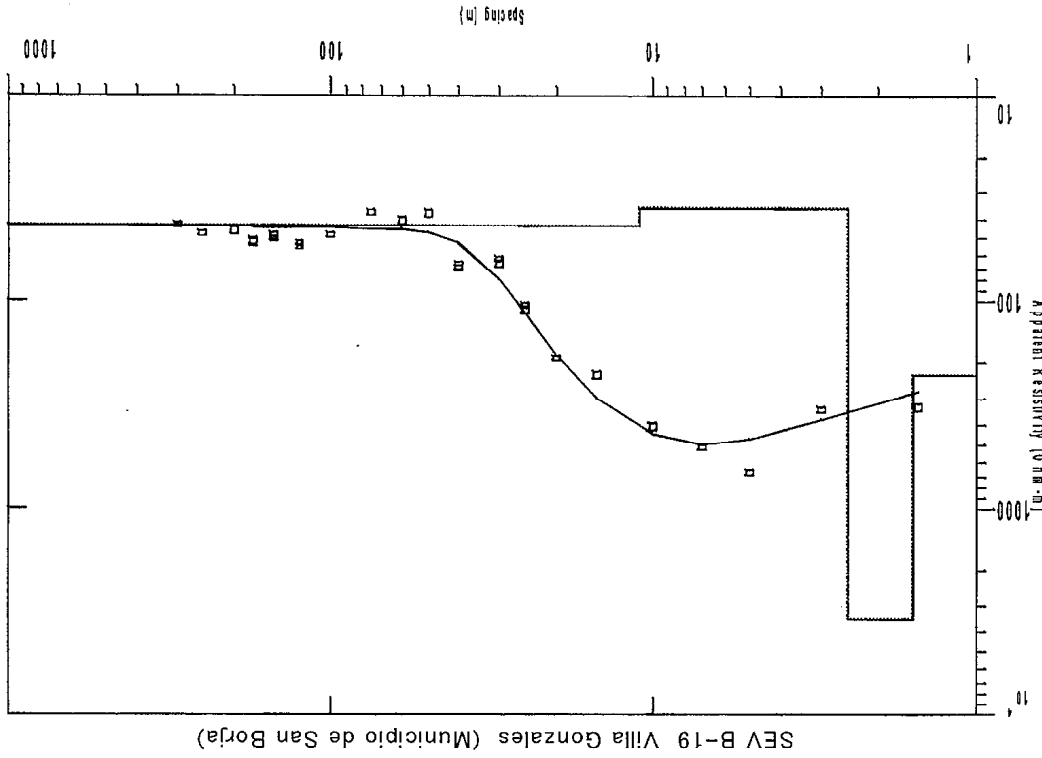
Layered Model

SEV 11 VILLA GONZALES

Page 2

L #	RESISTIVITY	THICKNESS (meters)	DEPTH	ELEVATION (meters)	LONG. COND. TRANS. RES. (Ohm-m ²)
1	230.4	1.56	1.56	-1.56	0.00679 360.4
2	3491.9	0.932	2.49	-2.49	2.671E-04 3256.8
3	35.27	8.61	11.10	-11.10	0.244 303.7
4	43.21				

ALL PARAMETERS ARE FREE



SEV B-19 Villa Gonzales (Municipio de San Boria)

SEV 20 CARMEN DEL MANIQUI

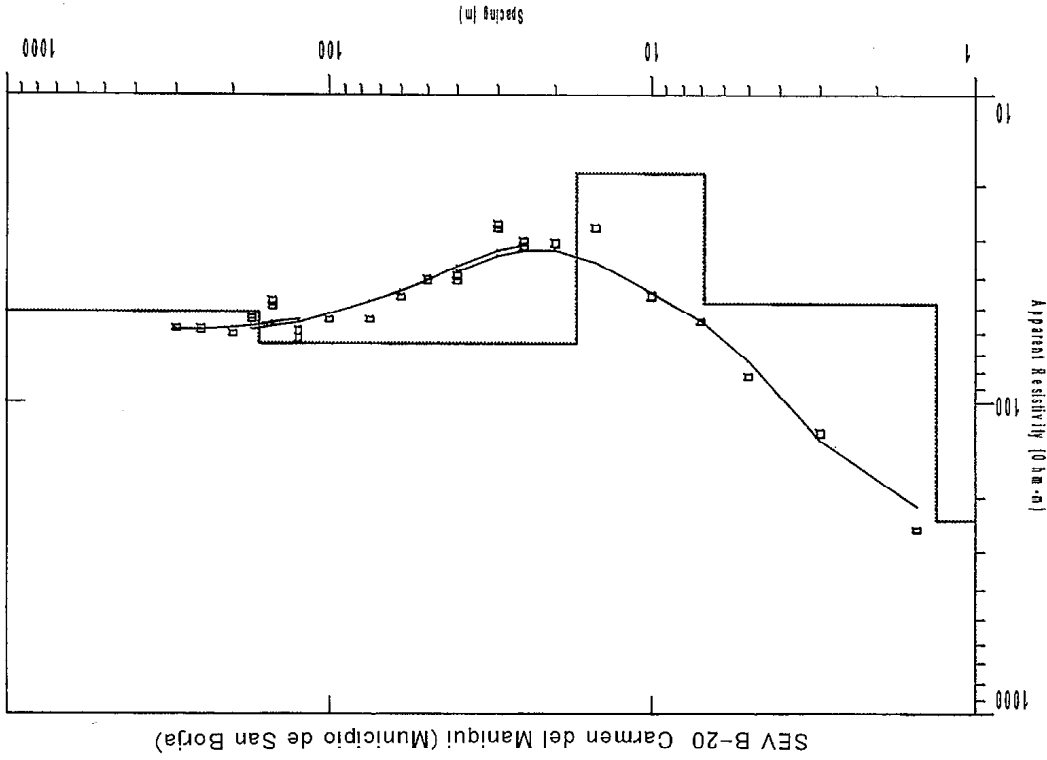
Schlumberger Array

Northing: 8347053.0 Easting: 748911.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters)	AB/2	Data Resistivity	Layered Model:		Smooth Model:	
				Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE
1	1.50	MN	255.8	215.0	15.95		
2	3.00		124.7	131.4	-6.39		
3	5.00		82.69	73.65	10.93		
4	7.00		55.02	54.87	0.215		
5	10.00		45.43	44.08	2.97		
6	15.00		27.32	35.48	-29.84		
7	20.00		30.64	32.25	-5.26		
8	25.00		31.59	32.15	-1.76		
9	30.00		27.41	33.56	-22.41		
10	40.00		40.70	37.68	7.42		
11	50.00		30.02	31.14	-3.72		
12	60.00		26.58	32.44	-22.07		
13	75.00		39.38	36.41	7.53		
14	100.00		40.35	40.29	0.148		
15	150.00		45.59	43.59	4.40		
16	200.00		54.36	47.52	12.58		
17	250.00		54.21	52.12	3.85		
18	300.00		62.24	55.12	11.43		
19	350.00		48.71	57.09	-17.19		
20	400.00		53.83	58.38	-8.45		
21	450.00		59.25	53.54	9.63		
22	500.00		47.12	55.51	-17.78		
23	550.00		52.40	56.79	-8.37		
24	600.00		60.36	57.60	4.58		
25	650.00		58.32	58.29	0.0416		
26	700.00		57.84	58.28	-0.757		

NO DATA ARE MASKED

Layered Model



SEV B-20 Carmen del Maniqui (Municipio de San Borja)

SEV 10 CARMEN DE MANIQUI

L #	RESISTIVITY	THICKNESS (meters)	DEPTH (meters)	ELEVATION (meters)	LONG. COND. TRANS. RES. (ohm-m ²)
1	235.8	1.31	1.31	-1.31	0.00557
2	48.02	5.57	6.88	-6.88	0.116
3	18.20	10.13	17.02	-17.02	0.356
4	65.02	148.8	165.8	-165.8	2.28
5	51.11				9876.9

ALL PARAMETERS ARE FREE

SEV 21 NARANJITOS

Schlumberger Array

Northing: 843989.0 Easting: 316554.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters)	AB/2	MN	Layered Model:		Smooth Model:	
				Data Resistivity	Synthetic Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE
1	1.50	0.500	70.56	55.96	20.68		
2	3.00	0.500	47.23	61.02	-29.17		
3	5.00	0.500	67.19	68.32	-1.87		
4	7.00	0.500	64.69	72.49	-12.06		
5	10.00	0.500	94.28	73.22	22.34		
6	15.00	0.500	73.07	65.82	9.92		
7	20.00	0.500	62.91	54.63	13.15		
8	25.00	0.500	27.08	43.98	-62.40		
9	30.00	0.500	21.19	35.43	-67.14		
10	40.00	0.500	25.63	24.64	3.83		
11	50.00	0.500	25.95	43.02	-65.76		
12	60.00	0.500	20.47	34.62	-69.07		
13	75.00	0.500	24.83	24.01	3.31		
14	100.00	0.500	18.73	18.88	-0.767		
15	150.00	0.500	18.30	16.39	10.45		
16	200.00	0.500	14.95	14.57	2.32		
17	250.00	0.500	14.72	12.88	12.49		
18	300.00	0.500	14.21	11.44	19.44		
19	400.00	0.500	12.00	10.04	16.32		
20	500.00	0.500	8.65	8.71	-0.706		
21	600.00	0.500	13.47	11.01	18.19		
22	750.00	0.500	11.54	9.66	16.25		
23	1000.00	0.500	8.29	8.38	-1.10		
24	1500.00	0.500	5.19	7.22	-39.11		
25	2000.00	0.500	4.66	5.37	-15.20		
26	3000.00	0.500	3.36	4.11	-22.08		

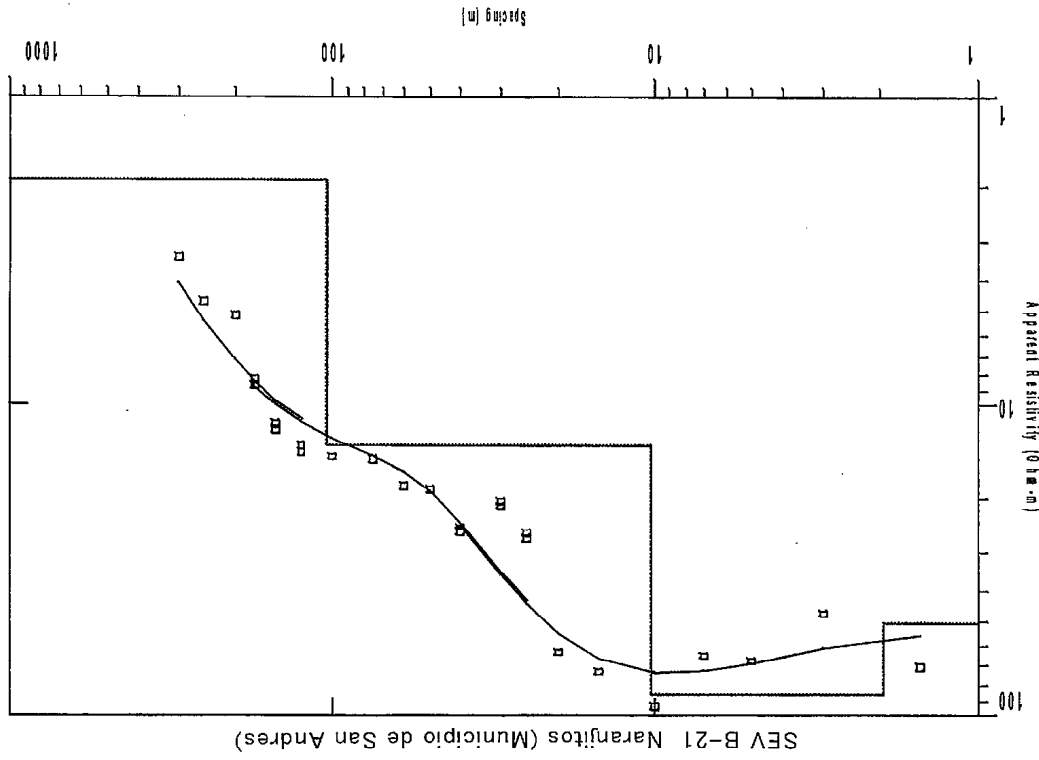
NO DATA ARE MASKED

Layered Model

SEV 20 NARANJITO

L #	RESISTIVITY	THICKNESS (meters)	DEPTH	ELEVATION (meters)	LONG. COND. TRANS. RES. (Ohm-m ²)
1	50.83	1.96	1.96	-1.96	0.0387
2	86.20	8.23	10.20	-10.20	0.0955
3	13.57	93.44	103.6	-103.6	6.88
4	1.89				1268.0

ALL PARAMETERS ARE FREE



【パンド県】

SEV 1 Puerto Rico

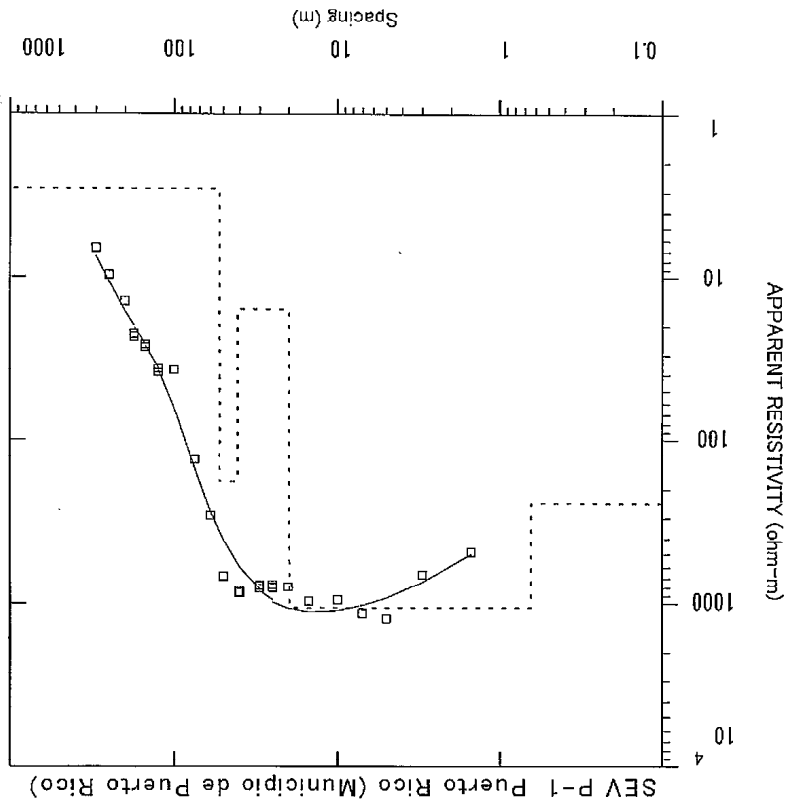
Schlumberger Array

Northing: 8772158.0 Easting: 658168.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters)	AB/2	MN	Layered Model:			Smooth Model:		
				Data Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	DIFFERENCE
1	1.50		0.50	485.6	510	-5.02%			
2	3.00		0.50	665.0	755	-13.53%			
3	5.00		0.50	1231.7	941.6	23.55%			
4	7.00		0.50	1138.6	1045.6	8.17%			
5	10.00		0.50	946.1	1122.9	-18.69%			
6	15.00		0.50	963.1	1145.1	-18.90%			
7	20.00		0.50	789.9	1094.9	-38.61%			
8	25.00		0.50	796.0	1003.7	-26.09%			
9	25.00		5.00	763.7	962.9	-26.08%			
10	30.00		0.50	798.0	854.7	-7.11%			
11	30.00		5.00	773.0	827.9	-7.10%			
12	40.00		0.50	726.0	608	16.25%			
13	40.00		5.00	706.0	591.3	16.25%			
14	50.00		5.00	458.0	408.4	10.83%			
15	60.00		5.00	291.0	273.4	6.05%			
16	75.00		5.00	132.0	149	-12.88%			
17	100.00		5.00	47.0	63.58	-35.28%			
18	125.00		5.00	38.2	37.56	1.68%			
19	125.00		25.00	36.4	35.79	1.68%			
20	150.00		5.00	26.8	26.45	1.31%			
21	150.00		25.00	25.8	25.46	1.32%			
22	175.00		5.00	23.1	20.35	11.90%			
23	175.00		25.00	22.3	19.64	11.93%			
24	200.00		25.00	14.1	15.99	-13.40%			
25	250.00		25.00	9.7	10.71	-10.41%			
26	300.00		25.00	6.7	7.42	-10.75%			

Layered Model

L #	Resistivity	Thickness	Depth
1	1031.0	13.65	13.65
2	11.2	14.27	27.92
3	474.0	33.49	61.41
4	6.88		



SEV 2 LOMA ALTA

Schlumberger Array

Northing: 8806302.0 Easting: 175468.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters)	AB/2	Data		Layered Model:		Smooth Model:	
			Resistivity	MN	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE
1	1.50	0.500	2430.8		2272.0	-1.54		
2	3.00	0.500	2271.7		2256.0	0.690		
3	5.00	0.500	2169.6		2195.8	-1.20		
4	7.00	0.500	2093.7		2082.6	0.529		
5	10.00	0.500	1707.5		1829.3	-7.43		
6	15.00	0.500	1313.9		1323.5	-0.735		
7	20.00	0.500	1060.8		890.3	16.07		
8	25.00	0.500	755.4		592.4	21.57		
9	30.00	0.500	411.8		407.7	0.997		
10	40.00	0.500	316.6		230.8	27.07		
11	25.00	5.00	724.7		596.8	17.64		
12	30.00	5.00	399.3		409.1	-2.44		
13	40.00	5.00	312.3		223.8	26.42		
14	50.00	5.00	159.3		159.3	-0.0180		
15	60.00	5.00	67.61		122.8	-81.75		
16	75.00	5.00	64.03		89.91	-40.41		
17	100.0	5.00	53.90		60.41	-12.09		
18	125.0	5.00	47.53		47.10	0.918		
19	150.0	5.00	36.00		41.13	-14.23		
20	175.0	5.00	26.91		38.34	-42.46		
21	125.0	25.00	45.31		45.73	-0.928		
22	150.0	25.00	38.05		39.68	-4.27		
23	175.0	25.00	25.82		36.88	-42.82		
24	200.0	25.00	23.25		35.47	-52.53		
25	250.0	25.00	29.54		34.21	-15.77		
26	300.0	25.00	30.32		33.66	-11.02		

NO DATA ARE MASKED

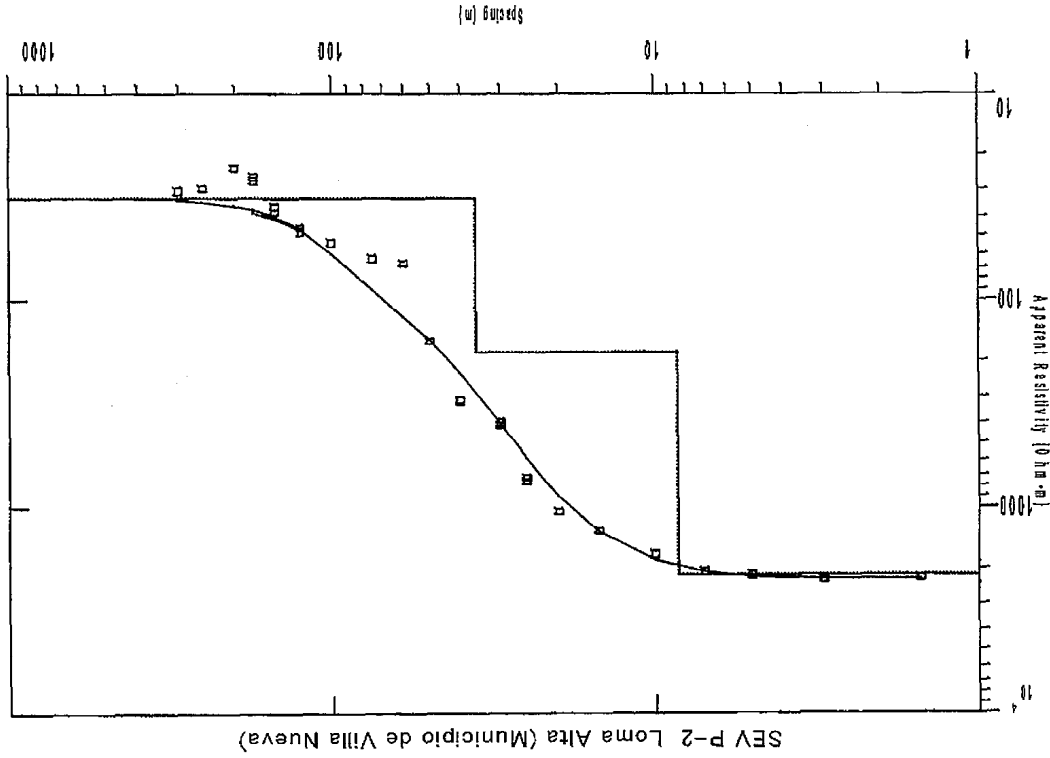
Layered Model

SEV 2 LOMA ALTA

Page 2

L #	RESISTIVITY	THICKNESS (meters)	DEPTH	ELEVATION (meters)	LONG. COND. TRANS. RES. (Siemens) (Ohm-m ²)
1	2152.9	8.48	8.48	0.0	0.00394
2	181.4	27.30	35.78	-8.48	0.150
3	32.67			-35.78	4955.2

ALL PARAMETERS ARE FREE



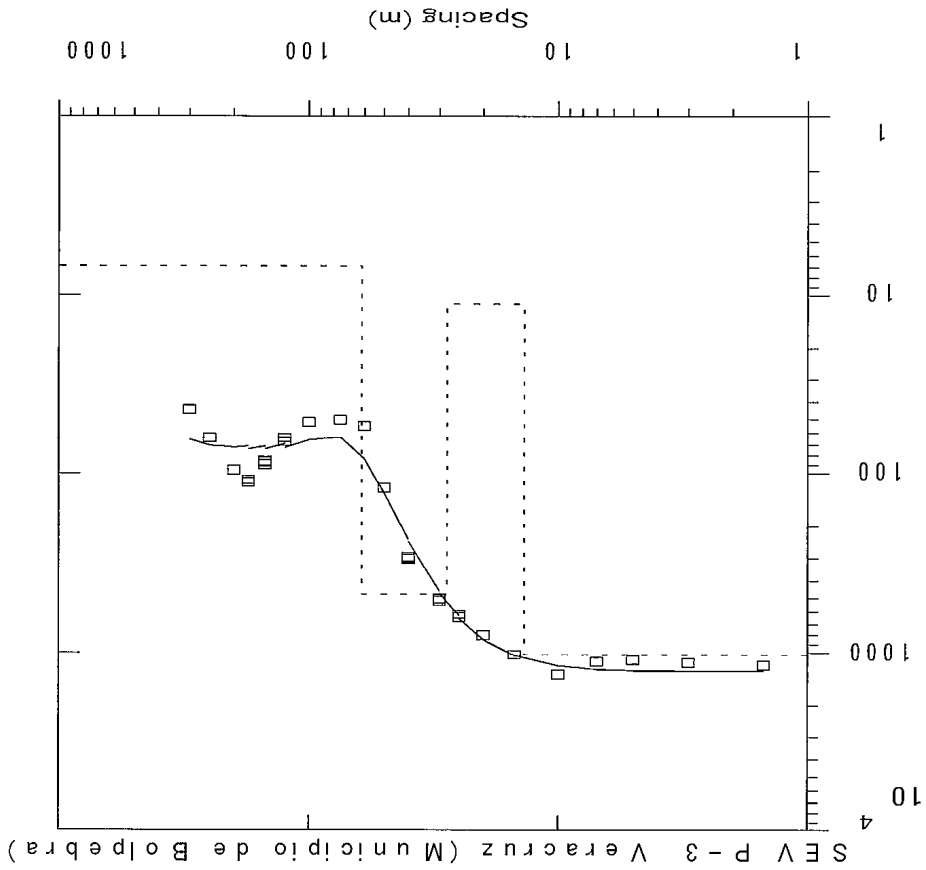
SEV 3 Veracruz
Schlumberger Array

Northing: 8748100.0 Easting: 485961.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters)	Layered Model:			Smooth Model:			
		AB/2	MN	Data Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE
1	1.50		0.50	1188.7	1276.8	-7.41%		
2	3.00		0.50	1145.3	1273.9	-11.23%		
3	5.00		0.50	1105.9	1263.8	-14.28%		
4	7.00		0.50	1132.8	1243	-9.73%		
5	10.00		0.50	1335.7	1187.9	11.07%		
6	15.00		0.50	1030.0	1037.7	-0.75%		
7	20.00		0.50	804.0	846.4	-5.27%		
8	25.00		0.50	641.6	654.5	-2.01%		
9	25.00		5.00	615.8	628.2	-2.01%		
10	30.00		0.50	519.2	468.2	9.82%		
11	30.00		5.00	503.9	454.4	9.82%		
12	40.00		0.50	300.5	240.6	19.93%		
13	40.00		5.00	294.4	235.7	19.94%		
14	50.00		5.00	121.2	129.6	-6.93%		
15	60.00		5.00	55.0	83.55	-51.83%		
16	75.00		5.00	50.5	63.4	-25.57%		
17	100.00		5.00	52.0	65.6	-26.11%		
18	125.00		5.00	67.1	72.66	-8.22%		
19	125.00		25.00	63.8	69.01	-8.22%		
20	150.00		5.00	89.7	73.85	17.64%		
21	150.00		25.00	86.3	71.06	17.64%		
22	175.00		5.00	112.7	73.67	34.63%		
23	175.00		25.00	109.1	71.32	34.63%		
24	200.00		25.00	96.0	72.2	24.78%		
25	250.00		25.00	63.8	70.3	-10.26%		
26	300.00		25.00	44.4	65.32	-47.25%		

Layered Model

L #	Resistivity	Thickness	Depth
1	1031.0	13.65	
2	11.2	14.27	27.92
3	474.0	33.49	61.41
4	6.88		



SEV 4 CURICHON
Schlumberger Array

Northing: 8679660 Easting: 546844.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters)	AB/2	M/N	Layered Model:			Smooth Model:		
				Data Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	DIFFERENCE
1	1.50	0.500	1326.5	1096.7	17.32				
2	3.00	0.500	1074.0	1171.1	-9.04				
3	5.00	0.500	1530.5	1283.1	16.16				
4	7.00	0.500	1280.6	1363.3	-6.45				
5	10.00	0.500	1457.1	1435.0	1.51				
6	15.00	0.500	1322.0	1487.1	-12.46				
7	20.00	0.500	1578.4	1488.5	5.60				
8	25.00	0.500	2046.3	1448.4	29.21				
9	30.00	0.500	1451.7	1372.9	5.43				
10	40.00	0.500	1299.1	1153.1	11.24				
11	25.00	5.00	1964.4	1425.7	27.42				
12	30.00	5.00	1411.6	1352.3	4.20				
13	40.00	5.00	1278.4	1136.9	11.06				
14	50.00	5.00	944.2	881.6	5.57				
15	60.00	5.00	468.1	666.2	-42.32				
16	75.00	5.00	206.5	405.3	-96.52				
17	100.00	5.00	177.6	185.2	7.00				
18	125.00	5.00	90.66	69.07	23.81				
19	150.00	5.00	87.43	34.42	64.66				
20	175.00	5.00	75.94	22.59	70.23				
21	125.00	25.00	86.19	71.81	16.68				
22	150.00	25.00	84.25	35.11	62.74				
23	175.00	25.00	74.45	22.58	69.66				
24	200.00	25.00	30.92	18.38	40.53				
25	250.00	25.00	24.10	16.41	31.91				
26	300.00	25.00	14.04	16.04	-14.30				

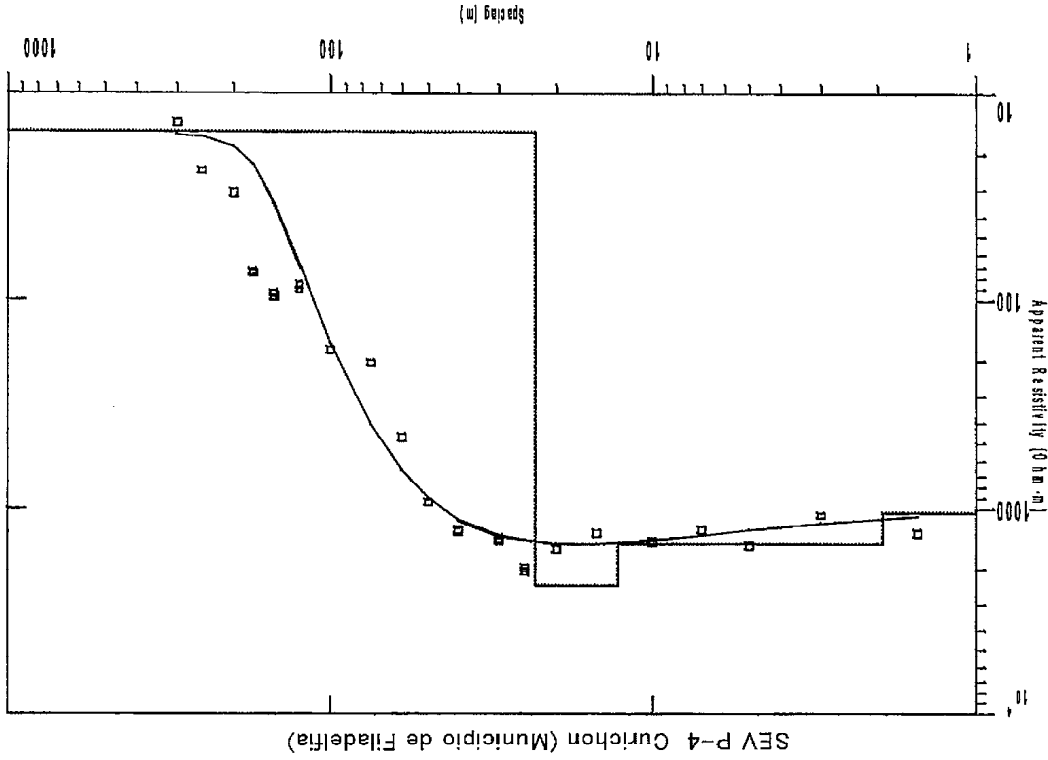
NO DATA ARE MASKED

Layered Model

Page 2

SEV 12 CURICHON	L #	RESISTIVITY	THICKNESS (meters)	DEPTH	ELEVATION (meters)	LONG. COND. TRANS. RES. (Siemens) (Ohm-m ²)
	1	1040.3	1.92	1.92	0.0	0.00185
	2	1493.6	10.85	12.77	-12.77	0.00727
	3	2393.4	10.47	23.25	-23.25	0.00438
	4	15.60				23076.2

ALL PARAMETERS ARE FREE



SEV 5 Vista Alegre

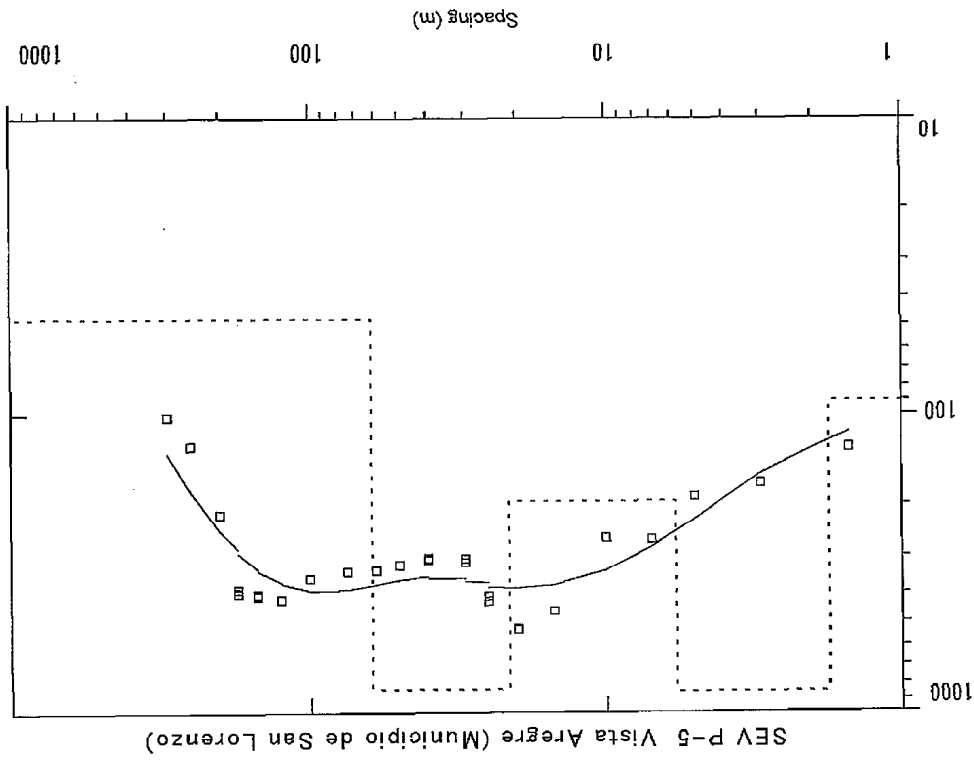
Schlumberger Array

Northing: 8733816.0 Easting: 753433.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters)	Layered Model:		Smooth Model:	
		Data Resistivity	Synthetic Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE
1	1.50	0.50	129.5	114.7	11.43%
2	3.00	0.50	169.6	157.9	6.90%
3	5.00	0.50	187.9	225	-19.74%
4	7.00	0.50	263.5	278.9	-5.84%
5	10.00	0.50	260.0	332.9	-28.04%
6	15.00	0.50	458.4	373.9	18.43%
7	20.00	0.50	529.5	383.4	27.59%
8	25.00	0.50	425.7	381.9	10.29%
9	25.00	5.00	408.6	366.5	10.30%
10	30.00	0.50	312.9	363.7	-16.24%
11	30.00	5.00	304.2	353.6	-16.24%
12	40.00	0.50	308.5	355.1	-15.11%
13	40.00	5.00	303.5	349.3	-15.09%
14	50.00	5.00	319.0	359.6	-12.73%
15	60.00	5.00	333.7	372.6	-11.66%
16	75.00	5.00	336.5	387.8	-15.25%
17	100.00	5.00	356.0	390.7	-9.75%
18	125.00	5.00	420.0	369.8	11.95%
19	125.00	25.00	418.0	368	11.96%
20	150.00	5.00	407.0	334.1	17.91%
21	150.00	25.00	401.0	329.1	17.93%
22	175.00	5.00	398.8	290.8	27.08%
23	175.00	25.00	387.1	282.3	27.07%
24	200.00	25.00	215.7	245.3	-13.72%
25	250.00	25.00	127.9	181.3	-41.75%
26	300.00	25.00	101.6	134.7	-32.58%

Layered Model

L #	Resistivity	Thickness	Depth
1	90.4	1.75	1.75
2	851.9	4.04	5.79
3	194.5	15.54	21.33
4	834.60	40.55	61.88
5		47.69	



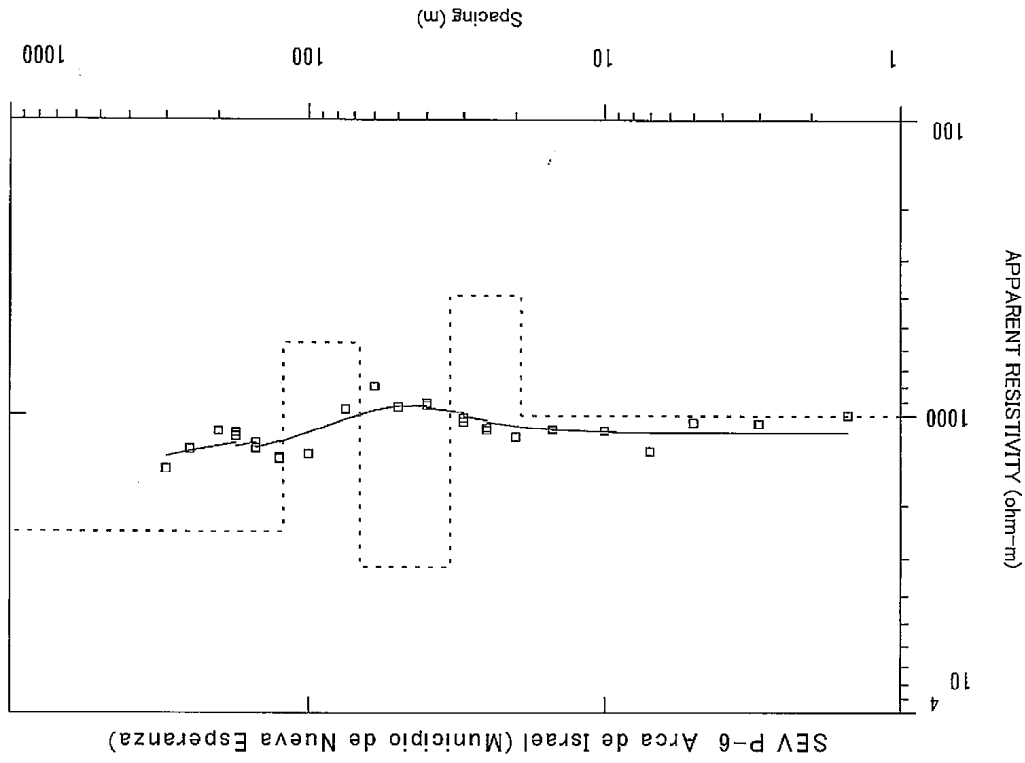
SEV 6 ARCA DE ISRAEL
Schlumberger Array

Northing: 8865658.0 Easting: 245894.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters)	Layered Model:		Smooth Model:	
		Data Resistivity	Synthetic Resistivity	Synthetic Resistivity	Synthetic Resistivity
	AB/2	MN			
1	1.50	0.50	1145.4	1145.4	-14.97%
2	3.00	0.50	1066.5	1145.1	-7.37%
3	5.00	0.50	1055.9	1144.1	-8.35%
4	7.00	0.50	1321.3	1142	13.57%
5	10.00	0.50	1125.7	1136	-0.91%
6	15.00	0.50	1117.4	1117.9	-0.04%
7	20.00	0.50	1190.6	1091.7	8.31%
8	25.00	0.50	1122.4	1062	5.38%
9	25.00	5.00	1102.7	1043.3	5.39%
10	30.00	0.50	1051.7	1016.1	3.38%
11	30.00	5.00	1022.2	987.6	3.38%
12	40.00	0.50	927.7	954.7	-2.91%
13	40.00	5.00	910.7	937.7	-2.96%
14	50.00	5.00	938.0	937.7	-2.86%
15	60.00	5.00	798.1	964.8	-29.18%
16	75.00	5.00	966.1	1031	-20.07%
17	100.00	5.00	1354.0	1148	8.60%
18	125.00	5.00	1401.0	1237.6	12.29%
19	150.00	25.00	1391.0	1228.8	11.66%
20	150.00	5.00	1295.6	1289.9	0.44%
21	150.00	25.00	1243.1	1237.7	0.43%
22	175.00	5.00	1179.5	1278.7	-8.41%
23	175.00	25.00	1147.7	1244.2	-8.41%
24	200.00	25.00	1132.3	1274.8	-12.59%
25	250.00	25.00	1301.3	1326.8	-1.96%
26	300.00	25.00	1512.3	1381	8.68%

Layered Model

L #	Resistivity	Thickness	Depth
1	986.7	19.16	19.16
2	391.7	33.37	52.53
3	3202.1	67.12	119.65
4	567.60	121.62	241.27
5	2438.70		



SEV 7 SANTA FE
Schlumberger Array

Northing: 8804636.0 Easting: 815373.0 Elevation: 0.0

N.O.	Spacing (meters) AB/2	Data Resistivity	Layered Model:		Smooth Model:	
			Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE
1	1.50	1060.8	1034.4	2.48		
2	3.00	867.8	1123.1	-16.04		
3	5.00	1230.7	1161.2	5.84		
4	7.00	1263.6	1157.1	8.42		
5	10.00	1180.2	1108.2	6.09		
6	15.00	976.3	953.5	2.33		
7	20.00	748.2	758.8	-1.41		
8	25.00	478.3	568.2	-18.79		
9	30.00	347.3	408.2	-17.52		
10	40.00	205.5	197.2	4.03		
11	25.00	459.7	566.9	-23.31		
12	30.00	336.6	407.6	-21.10		
13	40.00	202.5	196.9	2.74		
14	50.00	118.1	94.71	19.81		
15	60.00	50.00	50.26	23.49		
16	75.00	45.91	27.64	39.78		
17	100.00	20.68	20.98	-1.48		
18	125.00	22.05	20.56	6.76		
19	150.00	12.70	20.98	-65.74		
20	175.00	15.38	21.74	-41.39		
21	125.00	20.91	19.42	7.11		
22	150.00	12.50	19.80	-58.38		
23	175.00	14.51	20.51	-41.32		
24	200.00	16.32	21.45	-31.37		
25	250.00	20.21	23.90	-18.25		
26	300.00	25.27	26.94	-6.81		

NO DATA ARE MASKED

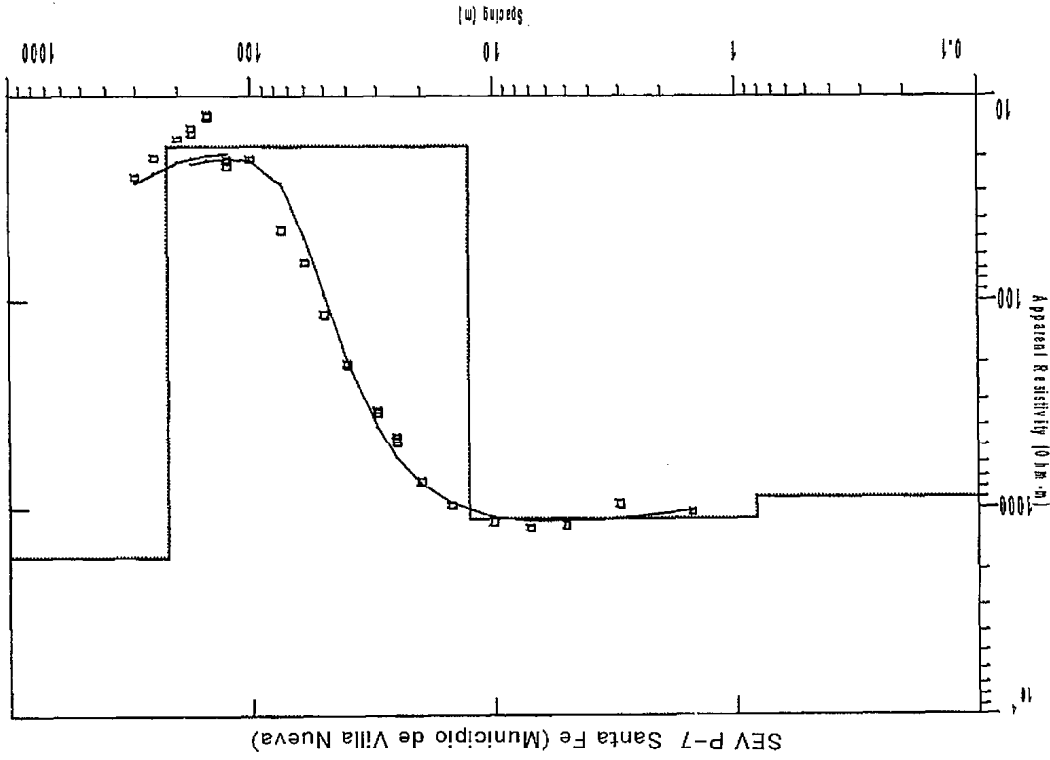
Layered Model

SEV 4 SANTA FE

Page 2

L #	RESISTIVITY	THICKNESS (meters)	DEPTH	ELEVATION (meters)	LONG. COND. TRANS. RES. (Ohm-m ²)
1	896.6	0.811	0.811	-0.811	9.049E-04
2	1135.4	11.92	12.73	-12.73	0.0105
3	17.72	207.5	220.2	-220.2	11.71
4	1754.5				3678.3

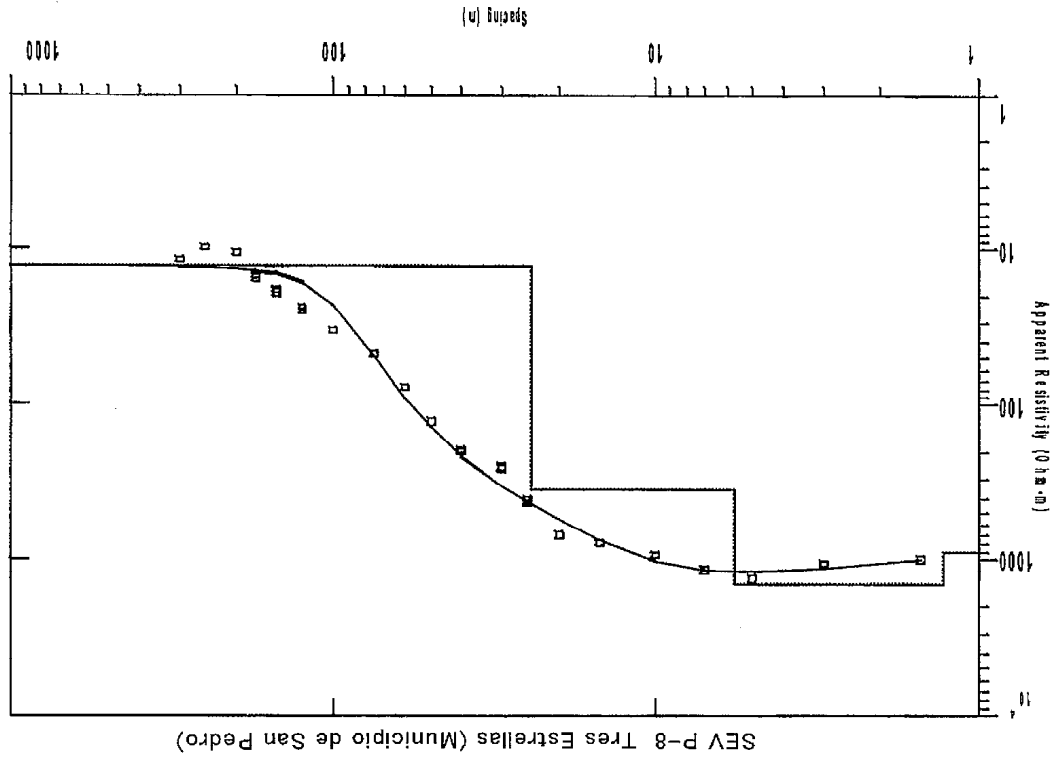
ALL PARAMETERS ARE FREE



SEV 8 TRES ESTRELLAS

Schlumberger Array

Northing: 878792.0 Easting: 757287.0 Elevation: 0.0



No.	Spacing (meters) AB/2	Data Resistivity MN	Layered Model:		Smooth Model:	
			Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE
1	1.50	1004.5	1000.6	0.393		
2	3.00	1077.2	1129.3	-4.83		
3	5.00	1341.6	1202.7	10.35		
4	7.00	1176.9	1167.9	0.767		
5	10.00	940.2	1020.2	-8.50		
6	15.00	0.500	780.2	4.37		
7	20.00	0.500	698.5	548.3	21.50	
8	25.00	0.500	429.6	420.1	2.20	
9	30.00	0.500	257.5	333.0	-29.33	
10	40.00	0.500	198.5	217.6	-9.62	
11	25.00	5.00	412.5	418.0	-1.33	
12	30.00	5.00	230.2	330.2	-31.97	
13	40.00	5.00	185.1	215.2	-10.29	
14	50.00	5.00	130.0	140.5	-8.14	
15	60.00	5.00	77.94	91.35	-17.20	
16	75.00	5.00	47.67	49.37	-3.56	
17	100.00	5.00	33.53	33.20	30.78	
18	125.00	5.00	24.99	16.52	33.89	
19	150.00	5.00	19.06	14.76	22.57	
20	175.00	5.00	15.38	14.20	7.67	
21	125.00	25.00	23.73	16.26	31.48	
22	150.00	25.00	18.27	14.35	21.44	
23	175.00	25.00	14.89	13.76	7.55	
24	200.00	25.00	10.63	13.82	-27.16	
25	250.00	25.00	9.72	13.31	-37.01	
26	300.00	25.00	11.79	13.21	-12.08	

NO DATA ARE MASKED

Layered Model

L #	RESISTIVITY	THICKNESS (meters)	DEPTH	ELEVATION	LONG. COND.	TRANS. RES. (Ohm-m ²)
1	900.8	1.27	1.27	0.0	0.00142	1151.3
2	1441.6	4.39	5.67	-1.27	0.00305	6336.8
3	349.3	18.88	24.35	-5.67	0.0534	627.2
4	13.01			-24.35		

ALL PARAMETERS ARE FREE

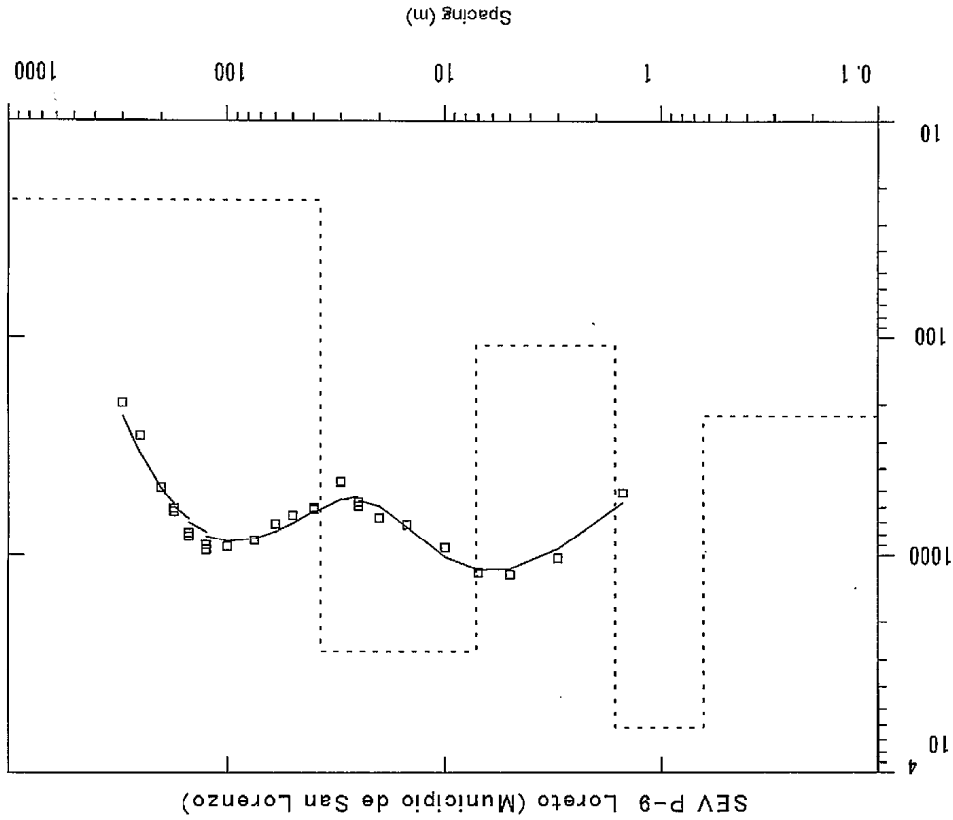
SEV 9 LORETO
Schlumberger Array

Northing: 8753144.0 Easting: 740115.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters)	Layered Model:		Smooth Model:	
		Data Resistivity	Synthetic Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE
1	1.50	514.4	570.7		-10.94%
2	3.00	1026.9	934.1		9.04%
3	5.00	1214.6	1148.4		5.45%
4	7.00	1187.4	1161.5		2.18%
5	10.00	923.0	1017.5		-10.24%
6	15.00	720.7	740.3		-2.72%
7	20.00	672.2	593.7		11.68%
8	25.00	593.1	557.7		5.97%
9	25.00	569.1	535.1		5.97%
10	30.00	460.0	555.4		-20.74%
11	30.00	455.0	549.4		-20.75%
12	40.00	613.6	637.9		-3.96%
13	40.00	603.3	627.2		-3.96%
14	50.00	654.9	712.4		-8.78%
15	60.00	718.9	777.9		-8.21%
16	75.00	852.0	838.9		1.54%
17	100.00	912.5	861.7		5.57%
18	125.00	942.4	819.1		13.08%
19	125.00	896.8	779.5		13.08%
20	150.00	817.6	705.1		13.76%
21	150.00	789.3	680.6		13.77%
22	175.00	629.6	595.1		5.48%
23	175.00	609.9	576.5		5.48%
24	200.00	486.8	492.1		-1.09%
25	250.00	281.8	341.8		-21.29%
26	300.00	197.6	229		-15.89%

Layered Model

L.#	Resistivity	Thickness	Depth
1	227.5	0.637807	0.637807
2	6147.0	0.993991	1.631798
3	108.3	5.52729	7.159088
4	2747.50	30.25	37.41
5		23.27	



SEV 10 AVAROA (PERLA DEL ACRE)

Schlumberger Array

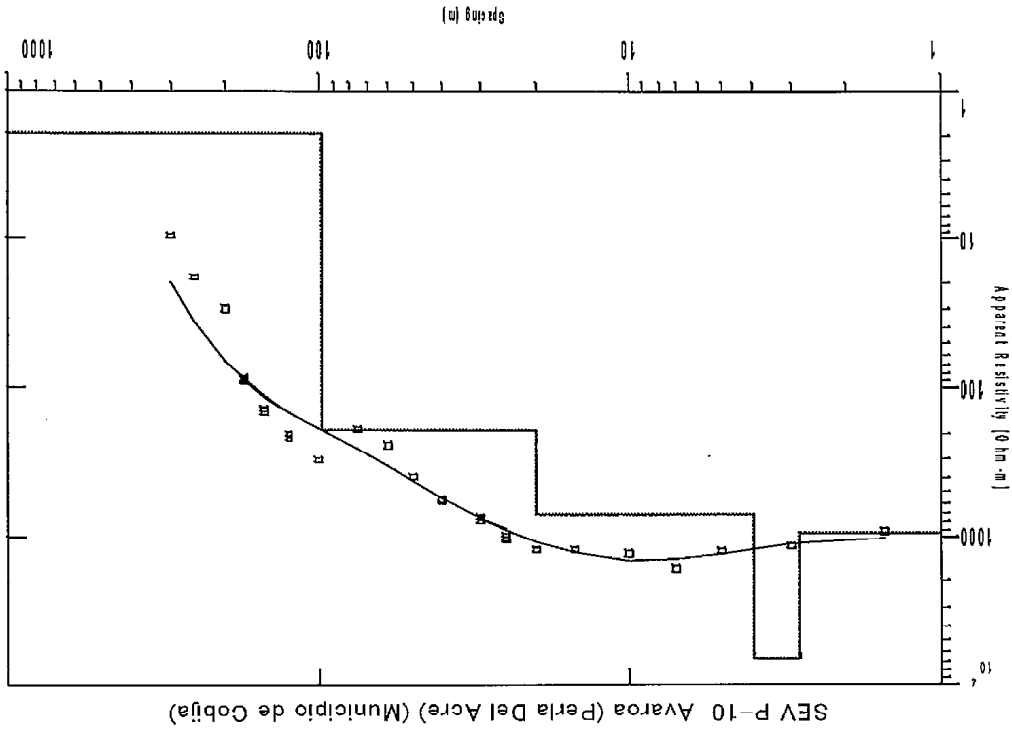
Nothing: 8779522.0 Easting: 523471.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters) AB/2	M/H	Data		Layered Model:		Smooth Model:	
			Resistivity	Difference	Synthetic Resistivity	Difference	Synthetic Resistivity	Difference
1	1.50	0.500	928.8	-9.61	1018.1	-9.61		
2	3.00	0.500	1159.6	3.92	1174.1	3.92		
3	5.00	0.500	1261.3	-2.52	1293.2	-2.52		
4	7.00	0.500	1650.6	14.40	1472.9	14.40		
5	10.00	0.500	1303.8	-10.48	1440.5	-10.48		
6	15.00	0.500	1217.3	-5.42	1283.3	-5.42		
7	20.00	0.500	1214.1	11.20	1078.1	11.20		
8	25.00	0.500	1042.3	899.7	899.7	13.68		
9	30.00	0.500	767.1	757.2	757.2	1.28		
10	40.00	0.500	566.4	554.9	554.9	2.02		
11	25.00	5.00	1007.1	889.4	889.4	11.15		
12	30.00	5.00	744.5	747.6	747.6	-0.416		
13	40.00	5.00	555.7	546.7	546.7	1.60		
14	50.00	5.00	395.5	418.1	418.1	-5.72		
15	60.00	5.00	244.1	334.1	334.1	-36.83		
16	75.00	5.00	190.5	257.0	257.0	-34.91		
17	100.00	5.00	302.0	189.3	189.3	37.32		
18	125.00	5.00	216.6	148.1	148.1	31.60		
19	150.00	5.00	143.3	116.1	116.1	18.99		
20	175.00	5.00	89.40	89.58	89.58	-0.198		
21	125.00	25.00	205.1	146.0	146.0	28.80		
22	150.00	25.00	138.6	114.3	114.3	17.54		
23	175.00	25.00	87.27	88.17	88.17	-1.02		
24	200.00	25.00	79.93	66.86	66.86	-123.3		
25	250.00	25.00	18.27	36.95	36.95	-102.2		
26	300.00	25.00	9.54	19.93	19.93	-108.8		

NO DATA ARE MASKED

L #	Layered Model			LONG. COND. TRANS. RES. (Semens) (Ohm-m ⁻²)
	RESISTIVITY (meters)	THICKNESS (meters)	DEPTH (meters)	
1	956.6	2.80	2.80	0.00293
2	6617.8	1.14	3.94	1.732E-04
3	712.1	15.96	19.91	0.0224
4	192.7	78.11	98.02	0.405
5	1.94			15154.1

ALL PARAMETERS ARE FREE



SEV 11 FLORIDA

Schlumberger Array

Northing: 8651601.0 Easting: ***** Elevation: 0.0

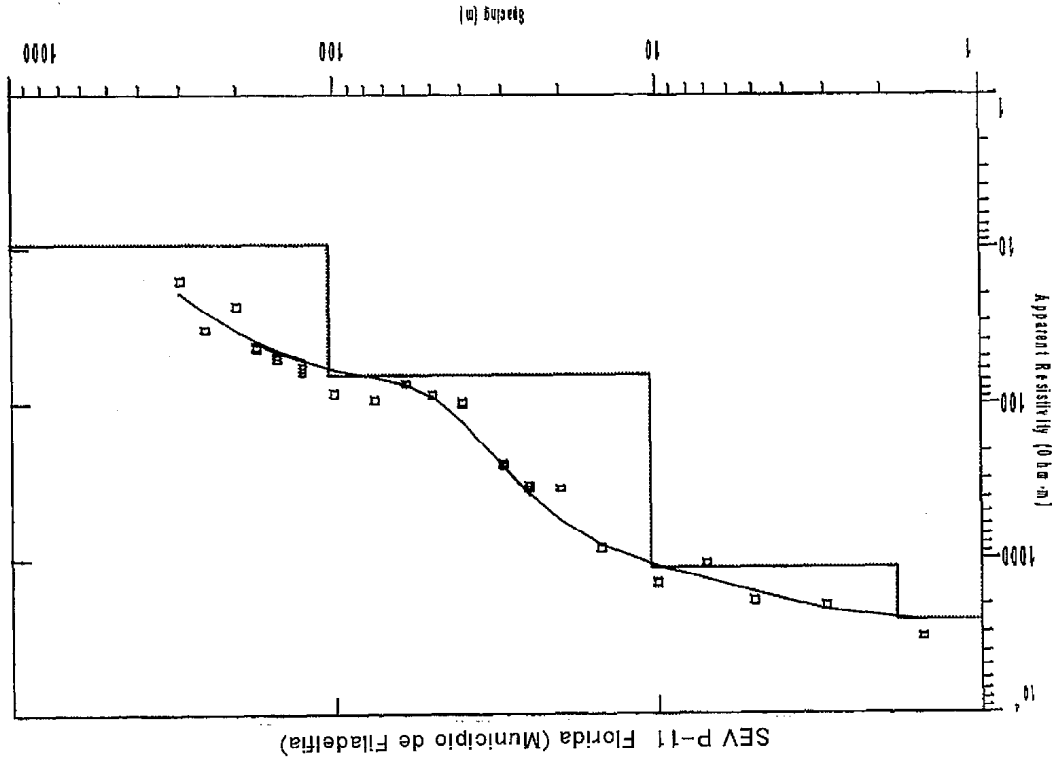
Layered Model: Smooth Model:
 Synthetic Synthetic
 Resistivity Resistivity
 DIFFERENCE DIFFERENCE

No.	Spacing (meters) AB/2 MN	Data Resistivity	Layered Model: Synthetic Resistivity	Layered Model: DIFFERENCE	Smooth Model: Synthetic Resistivity	Smooth Model: DIFFERENCE
1	1.50	3222.9	2635.6	2132		
2	3.00	0.500	2154.5	-6.43		
3	5.00	0.500	1887.7	1671.0		
4	7.00	0.500	1070.1	1382.6		
5	10.00	0.500	1447.7	1128.0		
6	15.00	0.500	855.5	816.8		
7	20.00	0.500	344.4	361.7		
8	25.00	0.500	347.0	374.6		
9	30.00	0.500	247.3	251.5		
10	40.00	0.500	99.00	131.2		
11	25.00	5.00	332.1	376.1		
12	30.00	5.00	240.3	251.9		
13	40.00	5.00	97.37	130.5		
14	50.00	5.00	87.16	89.30		
15	60.00	5.00	73.56	75.02		
16	75.00	5.00	93.94	67.11		
17	100.0	5.00	84.92	60.09		
18	125.0	5.00	61.75	53.58		
19	150.0	5.00	51.34	47.05		
20	175.0	5.00	44.22	40.83		
21	250.0	25.00	58.88	52.04		
22	150.0	25.00	49.60	45.70		
23	175.0	25.00	42.78	39.67		
24	200.0	25.00	23.30	34.22		
25	250.0	25.00	33.43	25.52		
26	300.0	25.00	16.28	19.63		

NO DATA ARE MASKED

L #	RESISTIVITY	THICKNESS (meters)	Layered Model DEPTH	ELEVATION (meters)	LONG. COND. TRANS. RES. (Siemens) (Ohm-m ⁻²)	RES.
1	2512.7	1.80	1.80	0.0	7.180E-04	4533.0
2	1135.1	8.65	10.46	-10.46	0.00762	8837.2
3	64.97	93.81	104.2	-104.2	1.44	6095.4
4	9.31					

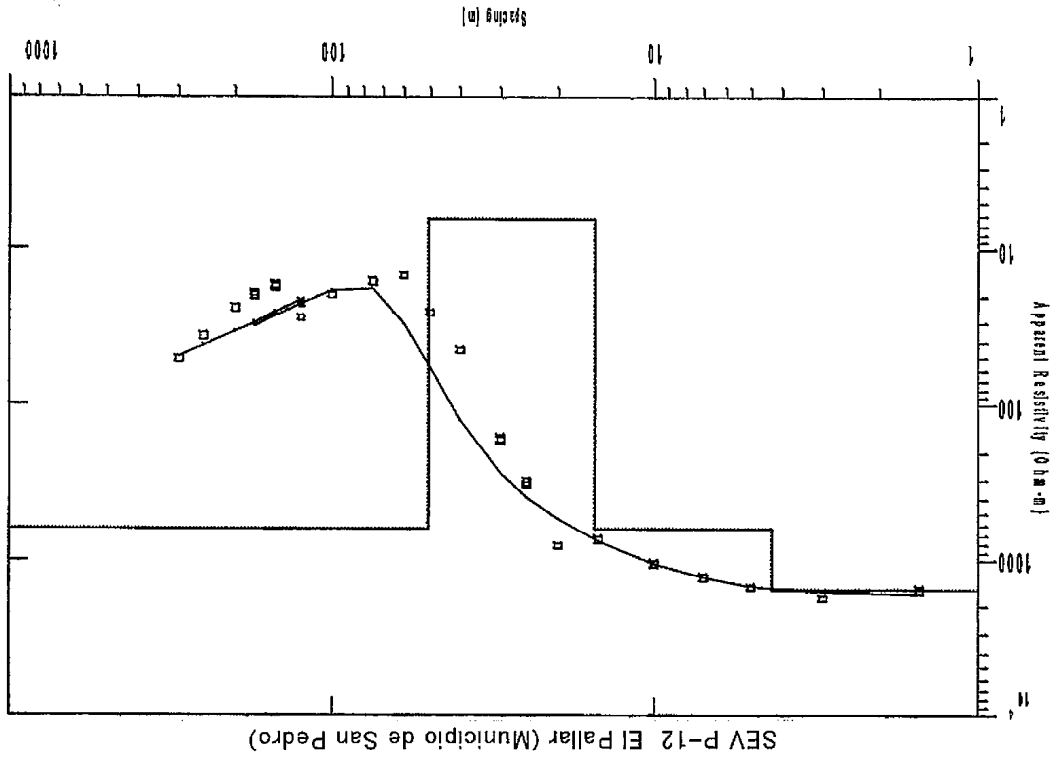
ALL PARAMETERS ARE FREE



SEV 12 EL PALLAR

Schlumberger Array

Northing: 8000124.0 Easting: 808130.0 Elevation: 0.0



No.	Spacing (meters) ABIZ	M/N	Data		Layered Model:		Smooth Model:	
			Resistivity	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	
1	1.50	0.500	1560.0	1666.6	-6.82			
2	3.00	0.500	1754.8	1623.2	7.49			
3	5.00	0.500	1504.9	1494.8	0.873			
4	7.00	0.500	1298.0	1320.8	-1.75			
5	10.00	0.500	1062.3	1064.8	-0.233			
6	15.00	0.500	732.4	750.0	-2.39			
7	20.00	0.500	807.6	539.5	33.19			
8	25.00	0.500	319.5	385.2	-20.56			
9	30.00	0.500	169.3	269.4	-59.14			
10	40.00	0.500	44.72	125.1	-179.8			
11	25.00	5.00	306.6	389.0	-26.89			
12	30.00	5.00	164.5	271.9	-66.26			
13	40.00	5.00	44.48	126.2	-183.8			
14	50.00	5.00	25.65	68.45	-127.8			
15	60.00	5.00	14.82	30.47	-105.5			
16	75.00	5.00	16.36	18.33	-12.04			
17	100.00	5.00	19.74	18.58	5.87			
18	125.00	5.00	27.93	22.61	19.06			
19	150.00	5.00	17.65	26.91	-52.46			
20	175.00	5.00	20.18	31.19	-54.51			
21	125.00	25.00	22.23	21.41	3.68			
22	150.00	25.00	17.17	25.52	-48.60			
23	175.00	25.00	19.22	29.61	-54.03			
24	200.00	25.00	24.24	33.65	-38.80			
25	250.00	25.00	36.93	41.59	-12.60			
26	300.00	25.00	51.66	49.32	4.52			

NO DATA ARE MASKED

L #	RESISTIVITY	THICKNESS (meters)	DEPTH (meters)	ELEVATION (meters)	LONG. COND. TRANS. RES.	
					(Stemens)	(Ohm-m ²)
1	1565.5	4.28	4.28	0.0	0.00270	6794.1
2	632.8	11.00	15.28	-15.28	0.0173	6961.8
3	630	35.32	50.61	-50.61	5.60	222.5
4	623.7					

ALL PARAMETERS ARE FREE

SEV 13 TRINIDADCITO
Schlumberger Array

Northing: 8764408.0 Easting: 764425.0 Elevation: 0.0

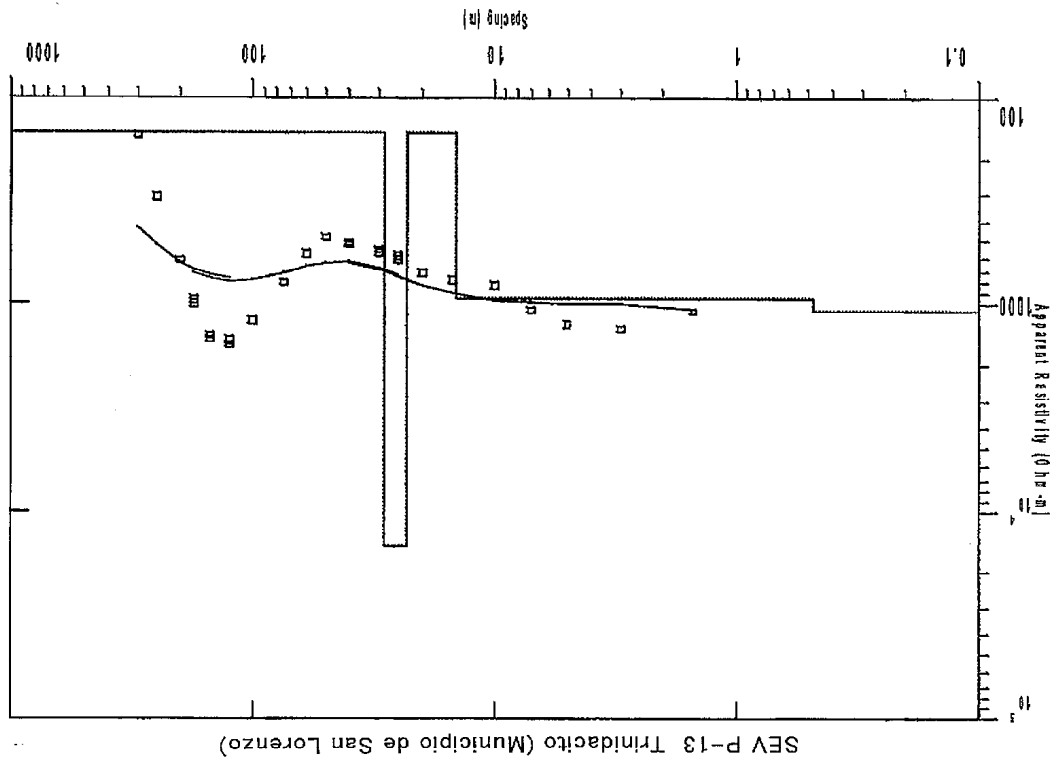
No.	Spacing (meters) AB/2	Data Resistivity MN	Layered Model:		Smooth Model:	
			Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE
1	1.50	1098.5	1059.8	3.52		
2	3.00	1346.3	1018.9	24.47		
3	5.00	1276.3	1001.1	21.56		
4	7.00	1074.7	989.2	7.95		
5	10.00	823.4	964.6	-17.14		
6	15.00	0.500	780.0	901.9	-15.62	
7	20.00	0.500	721.9	824.9	-14.26	
8	25.00	0.500	615.8	752.4	-22.17	
9	30.00	0.500	571.2	696.6	-21.94	
10	40.00	0.500	521.1	644.7	-23.72	
11	50.00	0.500	590.8	740.3	-25.30	
12	60.00	0.500	554.7	684.9	-23.46	
13	80.00	0.500	510.8	632.7	-23.87	
14	100.00	0.500	481.6	638.7	-32.59	
15	150.00	0.500	583.4	670.9	-14.93	
16	200.00	0.500	802.7	726.3	9.52	
17	300.00	0.500	1227.4	784.3	36.09	
18	450.00	0.500	1602.0	793.1	50.49	
19	750.00	0.500	1505.3	767.3	49.02	
20	1050.00	0.500	1407.4	721.2	28.40	
21	1500.00	0.500	1324.2	763.8	49.88	
22	2000.00	0.500	1150.3	740.1	48.96	
23	2500.00	0.500	971.5	696.2	28.33	
24	3000.00	0.500	624.1	642.2	-2.98	
25	3500.00	0.500	309.4	528.8	-70.83	
26	4000.00	0.500	154.4	428.8	-177.6	

NO DATA ARE MASKED

Layered Model

L #	RESISTIVITY	THICKNESS (meters)	DEPTH	ELEVATION (meters)	LONG. COND. TRANS. RES. (Ohm-m ²)
1	1091.7	0.478	0.478	-0.478	4.379E-04
2	945.0	14.09	14.57	-14.57	0.0149
3	150.5	8.50	23.07	-23.07	0.0564
4	14901.5	5.84	28.92	-28.92	3.995E-04
5	150.5				87166.0

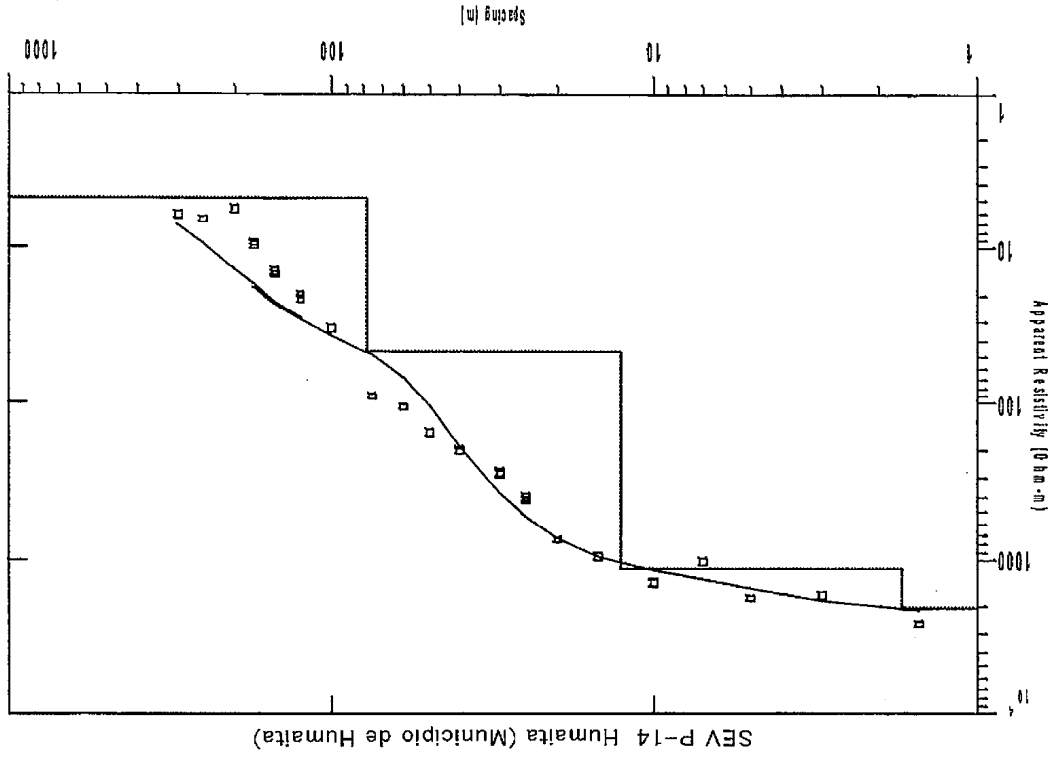
ALL PARAMETERS ARE FREE



SEV 14 HUMAITA

Schlumberger Array

Northing: 8635604.0 Easting: 564010.0 Elevation: 0.0



No.	Spacing (meters)	AB/2	Data Resistivity	Layered Model:		Smooth Model:	
				Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE
1	1.50	0.500	2626.5	2071.0	21.15		
2	3.00	0.500	1696.5	1822.7	-7.46		
3	5.00	0.500	1760.7	1524.3	13.42		
4	7.00	0.500	1030.4	1349.2	-30.93		
5	10.00	0.500	1414.3	1187.5	16.03		
6	15.00	0.500	954.4	951.1	-0.702		
7	20.00	0.500	740.0	736.8	0.435		
8	25.00	0.500	416.2	538.4	-29.35		
9	30.00	0.500	283.7	382.6	-34.81		
10	40.00	0.500	204.5	191.7	6.26		
11	25.00	5.00	399.7	537.2	-34.38		
12	30.00	5.00	275.8	381.7	-38.37		
13	40.00	5.00	201.1	190.9	5.10		
14	50.00	5.00	155.1	105.3	32.09		
15	60.00	5.00	105.9	68.41	34.46		
16	75.00	5.00	90.77	49.26	45.73		
17	100.0	5.00	32.90	37.05	-12.62		
18	125.0	5.00	21.07	29.21	-38.62		
19	150.0	5.00	14.82	22.87	-54.28		
20	175.0	5.00	9.61	17.93	-86.52		
21	225.0	25.00	19.97	28.34	-41.91		
22	150.0	25.00	14.28	22.18	-55.21		
23	175.0	25.00	9.23	17.37	-88.07		
24	200.0	25.00	5.69	13.78	-142.1		
25	250.0	25.00	6.60	9.36	-41.62		
26	300.0	25.00	6.17	7.20	-16.61		

NO DATA ARE MASKED

Layered Model

L #	RESISTIVITY	THICKNESS (meters)	DEPTH (meters)	ELEVATION (meters)	LONG. COND. TRANS. RES. (Ohm-m ²)
1	2024.8	1.70	1.70	0.0	3461.3
2	1152.0	10.90	12.60	-12.60	12557.6
3	46.92	65.83	78.44	-78.44	1.40
4	4.91	4.91	78.44	-78.44	3088.9

ALL PARAMETERS ARE FREE

SEV 15 SANTA CRUCITO
Schlumberger Array

Northing: 8012192.0 Easting: 181683.0 Elevation: 0.0

No.	Spacing (meters)	AB/2	Data Resistivity	Layered Model:		Smooth Model:	
				Synthetic Resistivity	DIFFERENCE	Synthetic Resistivity	DIFFERENCE
1	1.50	0.500	2134.1	2228.4	-4.41		
2	3.00	0.500	2437.5	2208.9	9.37		
3	5.00	0.500	2242.5	2149.4	4.15		
4	7.00	0.500	1813.5	2065.2	-13.88		
5	10.00	0.500	1873.5	1931.5	-3.99		
6	15.00	0.500	1793.6	1736.2	3.19		
7	20.00	0.500	1705.0	1561.4	8.42		
8	25.00	0.500	1638.4	1385.3	15.41		
9	30.00	0.500	1372.6	1205.5	12.10		
10	40.00	0.500	838.7	863.0	-2.88		
11	50.00	5.00	1572.7	1367.3	13.03		
12	30.00	5.00	1333.4	1190.8	10.69		
13	40.00	5.00	824.4	852.1	-3.35		
14	50.00	5.00	495.9	573.0	-15.55		
15	60.00	5.00	232.0	369.8	-59.37		
16	75.00	5.00	104.3	185.0	-77.35		
17	100.0	5.00	79.28	62.35	21.34		
18	125.0	5.00	51.45	29.84	42.01		
19	150.0	5.00	36.00	21.75	39.58		
20	175.0	5.00	8.65	19.68	-127.5		
21	125.0	25.00	48.79	32.63	33.11		
22	150.0	25.00	20.88	23.07	-10.51		
23	175.0	25.00	9.04	20.66	-128.4		
24	200.0	25.00	10.39	19.95	-92.85		
25	250.0	25.00	15.16	19.53	-28.82		
26	300.0	25.00	20.21	19.37	4.17		

NO DATA ARE MASKED

L #	RESISTIVITY	THICKNESS (meters)	Layered Model		
			DEPTH (meters)	ELEVATION (meters)	LONG. COND. TRANS. RES. (Ohm-m ²)
1	2294.1	4.37	4.37	0.0	10041.0
2	1705.6	18.43	22.81	-42.81	31444.3
3	19.05				

ALL PARAMETERS ARE FREE

